原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿

# 平成25年度海水及び ホウ酸注入影響評価試験

成果報告書

平成 26 年 3 月

一般財団法人 電力中央研究所

原子力技術研究所

## 目次

1	. 緒言		1
2	. 既往	研究の調査	2
	2.1.	無機物の水に対する溶解度	2
	2.2.	硫酸カルシウムの溶解度	2
	2.3.	塩化ナトリウムとホウ酸の混合溶液の溶解度	2
3	燃料	バンドル除熱性能	9
	3.1.	塩水採取システムの改良	9
	3.2.	差圧計測法の改良	18
	3.3.	沸騰濃縮試験と析出塩の X 線 CT 撮影	22
	3.3.1.	短尺バンドル試験装置	22
	3.3.2.	X 線 CT 撮影設備	37
	3.3.3.	沸騰濃縮試験手順	43
	3.3.4.	試験溶液	47
	3.3.5.	沸騰濃縮液の成分分析方法	48
	3.3.6.	沸騰濃縮試験パラメータ	49
	3.3.7.	沸騰濃縮試験結果	52
4	. クラ	スト・デブリベッド冷却特性1	16
	4.1.	クラスト・デブリベッド模擬試験装置1	16
	4.2.	プール沸騰試験パラメータ1	23
	4.3.	プール沸騰試験手順1	25
	4.4.	プール沸騰試験結果および考察1	26
5	まと	Ø1	35

## 表目次

表 2-1	無機物の水に対する溶解度4
表 2-2	塩化ナトリウムとホウ酸の溶解度6
表 3-1	五ホウ酸ナトリウム水和水の自動採取結果16
表 3-2	人工海水の自動採取結果17
表 3-3	塩分拡散防止効果試験における塩分濃度測定結果19
表 3-4	短尺バンドル試験体構成部材の概略仕様一覧34
表 3-5	X線撮影装置の仕様
表 3-6	人工海水の成分
表 3-7	短尺バンドル内沸騰濃縮試験パラメータ51
表 3-8	短尺バンドル試験条件の命名法51
表 3-9	沸騰濃縮試験結果55
表 3-10	TAF 高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF)101
表 3-11	TAF 高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 100 mm) 102
表 3-12	TAF 高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 200 mm) 103
表 3-13	スペーサ高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF) 104
表 3-14	スペーサ高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 100 mm) 105
表 3-15	スペーサ高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 200 mm) 106
表 3-16	鉛直断面の析出塩分布一覧(液位 TAF) 107
表 3-17	鉛直断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 100 mm)108
表 3-18	鉛直断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 200 mm)
表 3-19	溶液中の濃度分布(液位 TAF、全濃度範囲)110
表 3-20	溶液中の濃度分布(液位 TAF、濃度範囲拡大)111
表 3-21	溶液中の濃度分布(液位 TAF - 100 mm、全濃度範囲)112
表 3-22	溶液中の濃度分布(液位 TAF - 100 mm、濃度範囲拡大)113
表 3-23	溶液中の濃度分布(液位 TAF - 200 mm、全濃度範囲)114
表 3-24	溶液中の濃度分布(液位 TAF - 200 mm、濃度範囲拡大)115
表 4-1	プール沸騰試験パラメータ124
表 4-2	プール沸騰試験条件の命名法124

## 図目次

図 2-1	各種硫酸カルシウム(石こう)の溶解度	7
図 2-2	塩化物共存溶液に対する二水硫酸カルシウム(石こう)	溶解度8
図 3-1	塩水自動採取システムの概念図	
図 3-2	改良に用いたステンレスマイクロシリンジポンプ	14
図 3-3	五ホウ酸ナトリウム水和水濃度と導電率の関係	15
図 3-4	人工海水濃度と導電率との関係	15
図 3-5	計装配管継手の構造図	
図 3-6	差圧計導管改良部の塩分拡散防止効果確認試験の様子	
図 3-7	短尺バンドル試験装置の概念図	
図 3-8	試験バンドルのロッド配列及び熱電対位置	
図 3-9	短尺ヒータロッド形状寸法図	
図 3-10	短尺バンドル試験体の概念図	
図 3-11	5×5バンドル試験スペーサの形状寸法	
図 3-12	サンプリングポートの位置および構造	
図 3-13	X線CT設備の回転試料台とフラットパネル	39
図 3-14	X線CT撮影用の台座	40
図 3-15	上部から見た短尺バンドル撮影位置と向き	41
図 3-16	高さ方向の撮影範囲	
図 3-17	X線CT撮影像による析出塩分布 SH1L	56
図 3-18	X線CT撮影像による析出塩分布 SH2L	57
図 3-19	X線CT撮影像による析出塩分布 SH3L	58
図 3-20	X線CT撮影像による析出塩分布 SH4L	59
図 3-21	X線CT撮影像による析出塩分布 SH5L	60
図 3-22	X線CT撮影像による析出塩分布 SH1M	61
図 3-23	X線CT撮影像による析出塩分布 SH2M	
図 3-24	X線CT撮影像による析出塩分布 SH3M	63
図 3-25	X線CT撮影像による析出塩分布SH4M	64
図 3-26	X線CT撮影像による析出塩分布SH5M	65
図 3-27	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SH1H	66

図 3-28	X線CT撮影像による析出塩分布SH2H	67
図 3-29	X線CT撮影像による析出塩分布SH3H	68
図 3-30	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SH4H	69
図 3-31	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SH5H	70
図 3-32	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM1L	71
図 3-33	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM2L	72
図 3-34	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM3L	73
図 3-35	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM4L	74
図 3-36	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM5L	75
図 3-37	X線CT撮影像による析出塩分布 SM1M	76
図 3-38	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM2M	77
図 3-39	X線CT撮影像による析出塩分布 SM3M	78
図 3-40	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM4M	79
図 3-41	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM5M	80
図 3-42	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM1H	81
図 3-43	X線CT撮影像による析出塩分布 SM2H	82
図 3-44	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM3H	83
図 3-45	X線CT撮影像による析出塩分布 SM4H	84
図 3-46	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SM5H	85
図 3-47	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL1L	86
図 3-48	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL2L	87
図 3-49	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL3L	88
図 3-50	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL4L	89
図 3-51	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL5L	90
図 3-52	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL1M	91
図 3-53	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL2M	92
図 3-54	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL3M	93
図 3-55	X線CT撮影像による析出塩分布SL4M	94
図 3-56	X線CT撮影像による析出塩分布SL5M	95
図 3-57	X線CT撮影像による析出塩分布SL1H	96
図 3-58	X線CT撮影像による析出塩分布 SL2H	97

図 3-59	X線CT撮影像による析出塩分布 SL3H	
図 3-60	X 線 CT 撮影像による析出塩分布 SL4H	
図 3-61	X線CT撮影像による析出塩分布 SL5H	
図 4-1	クラスト・デブリベット試験装置の構造概念	
図 4-2	クラスト・デブリベット試験装置の概念図	
図 4-3	伝熱面内の熱電対配置図	
図 4-4	伝熱面熱電対の配置図	
図 4-5	クラスト・デブリベット試験体と伝熱面の概念図	
図 4-6	伝熱面表面温度の時間変化 W,S01L	
図 4-7	伝熱面表面温度の時間変化 W,S03L	
図 4-8	伝熱面表面温度の時間変化 W,S05L	
図 4-9	伝熱面表面温度の時間変化 W,S10L	
図 4-10	伝熱面表面温度の時間変化 W,S12L	
図 4-11	伝熱面表面温度の時間変化 W,S01M	
図 4-12	伝熱面表面温度の時間変化 W,S03M	
図 4-13	伝熱面表面温度の時間変化 W,S05M	
図 4-14	伝熱面表面温度の時間変化 W,S10M	
図 4-15	伝熱面表面温度の時間変化 W,S12M	
図 4-16	伝熱面表面温度の時間変化 W,S01H	
図 4-17	伝熱面表面温度の時間変化 W,S03H	
図 4-18	伝熱面表面温度の時間変化 W,S05H	
図 4-19	伝熱面表面温度の時間変化 W,S10H	
図 4-20	伝熱面表面温度の時間時間変化 W,S12H	

#### 1. 緒言

原子炉施設における過酷事故発生時の事故緩和策として、水源が枯渇した後 に海水が原子炉や使用済み燃料ピットに注入される状況において、海水やホウ 酸水またはそれらの混合溶液に曝された燃料の除熱特性を適切に把握し、対策 に活用することは重要である。また、燃料が溶融して、クラストやデブリベッ ド状に堆積した際の除熱特性を適切に把握して安全評価の精度を向上させる必 要がある。

本研究は、独立行政法人原子力安全基盤機構殿からの委託研究「平成25年 度海水及びホウ酸注入影響評価試験」において、昨年度に引き続き海水が注水 される場合の熱物性値や熱伝達に関する既往研究で得られている知見を明らか にすると共に、模擬炉心である燃料バンドル体系および模擬クラスト・デブリ ベッドである多孔質体を対象に除熱性能を明らかにすることである。

#### 2. 既往研究の調査

昨年度は、海水およびホウ酸水の物性値を調査した。本年度は更なる調査を 行い、海水の沸騰濃縮において、早期にかつ顕著な量として析出する可能性が ある硫酸カルシウムについて重点的に調査を行った。

#### 2.1. 無機物の水に対する溶解度

表 2-1 に、100g の飽和溶液中に溶存する各無機物の量をグラム(g)でで示す。 すべて化学式に示された無水物の重量として表してある。\*印は 100g の水に溶 解する量を表す。温度の関数として報告されている。この表において硫酸ナト リウムは 40℃において最大値となり、温度が低くなっても、高くなっても溶解 度は減少する。

#### 2.2. 硫酸カルシウムの溶解度

図 2-1 に各種硫酸カルシウムの溶解度を温度の関数として示す。二水塩では 温度と共に溶解度が上昇するのに対し、半水塩及び無水塩では温度の上昇と共 に溶解度が減少する。

図 2-2 に塩化物イオンが共存する溶液の硫酸カルシウムの溶解度を示す。温 度の関数として溶解度が得られている。塩化物イオン濃度が増大するに従い、 溶解度が減少する。

#### 2.3. 塩化ナトリウムとホウ酸の混合溶液の溶解度

秋田大学大学院工学資源学研究科の金児らの研究は、原子炉圧力容器の炭素 鋼を用いた腐食試験を行い、塩化ナトリウムとホウ酸の混合溶液中での腐食量 を測定した。表 2-2 に、試験溶液の濃度(上段)と溶液温度に対する飽和溶解 度が示されている。腐食試験の結果、塩化ナトリウム水溶液中では腐食量が少 ないが、ホウ酸水溶液中では腐食量は顕著に多く、それらの混合溶液中ではさ らに腐食量が増大した。

同論文には、混合溶液の溶解度について実験結果が記されている。すなわち、「373 K で NaCl 飽和濃度は 7.149 mol/kg, H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 飽和濃度は 6.797 mol/kg で,単 独の場合よりも溶解度が増す」との記載がある。ホウ酸との混合溶液の情報が 少ない中では、貴重な情報である。 参考文献

[1] 理科年表平成 15 年、丸善㈱、国立天文台編

http://ebw.eng-book.com/pdfs/15a5c5843afad2fbc8b558fbab15aa80.pdf

[2] 橋本壽夫, たばこ塩産業 塩事業版, 2007

http://www.geocities.jp/t\_hashimotoodawara/salt6/salt6-07-02.html

[3] 金児紘征、中川時子、平泉浩成「NaCl-H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> 水溶液における原子炉圧力容 器材料の加速腐食試験」,日本金属学会誌, 76-11 (2012), 615-623.

物费	化学式	30	20°C	40°C	60°C	80°C	100°C
(無水)亜ヒ酸(六酸化四ヒ素)	As <sub>4</sub> O <sub>6</sub>	1.21	1.81	2.93	4.45(62*)	5.62 (75*)	8.18(98.5*)
アンモニウムミョウバン	AI(NH4)(SO4)2	2.97	5.91	14.41 (45*)	22.0(55*)	47.3(85*)	
亜硫酸ナトリウム*	Na <sub>2</sub> SO <sub>2</sub>	13.3	$30.7(25^{\circ})$	35.7	31.7	28.0	26.3
塩化アンモニウム*	NHAT	29.4	37.2	45.8	55.2	65.6	77.3
	KCI	21.92	25.5	28.6	31.4	33.9	36.0
カルシウム	CaCh	37.3	42.7	53.4	57.8	59.5	61.4
	AgCI	0.000070	0.000155	0.00036			0.0021
-== /(l/) (11)	CoCh	30.3	34.6	41.0	48.4	49.4	51.5
-ストロンチウム	SrCb	30.3	35.8(25*)	39.5	45.0	47.5	50.2
-セシウム	CACI	61.7	65.1	67.5	69.7	71.4	73.0
—木銀(1)	HgCl	3.5	6.1	9.3	14.4	23.4	36.5
- 銀(1)	Hg-Cl:	0.000140	0.000038	_	-		
-鉄(目)	FeCh	42.66	47.88	60.01 (37°)	78.86	84.03	84.26
—鉄(目)	FeClg	33.2	38.5	40.7	43.9	-	45.7
ダリウム	TICI	1.6	3.9(25*)		C 386-1		(1993)
ナトリウム	NaCl	26.28	26.38	26.65	27.05	27.54	28.2
-ニッケル	NiCle	34.8	38.29		44.8	45.96	46.7
—バリウム	BaCl <sub>2</sub>	23.8	26.30	28.9	31.6	34.3	37.0
-マグネシウム	MgCh	34.6	35.3	36.5	37.9	39.8	42.3
—ルビジウム	RECI	43.5	47.7	50.9	53.6	56.0	58.9
塩素酸カリウム	KClO <sub>2</sub>	3.2	6.8	12.2	19.2	27.3	36.0
過塩素酸ナトリウム	NaClO <sub>4</sub>	62.87	67.82(25))	70.38(38*)	-	-	76.75
	K <sub>4</sub> Fe(CN) <sub>4</sub>	12.5	22.0	27.8 (35')	36.8(65*)	40.1	42.63
過マンガン酸カリウム	KMnO <sub>k</sub>	2.75	5.96	11.13	18.15		
クロム酸カリウム*	K2CrOa	58.8	63.9	68.0	72.2	76.3	80.1
クロムミョウパン*	CrK(SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>		12.51(25°)	5.00 C	1.111.1	57022	540.02
島化カリウム	KBr	34.9	39.4	43.2	46.1	48.7	51.0
一約*	PbBr <sub>2</sub>	0.4554	0.9744(25*)	1.7457(45°)	2.574 (65*)	3.343	4.751
ーナトリウム	NaBr	44.47	10.000		54.10		
硝酸アンモニウム	NH <sub>4</sub> No <sub>3</sub>	54.2	65.5	74.6	80.7	85.7	90.3
一里前	$Zn(NO_3)_2$	48.3(0.4*)	58.1 (30*)	70.2(45*)	87.2(59*)		-
ーカリウム	KNO <sub>1</sub>	11.7	24.0	39.0	52.2	62.8	71.0

物質	化学式	010	3010	40°C	60°C	30°C	1007
60.992.50	AgNO <sub>1</sub>	54.8	68.4	75.7	81.5	85.4	88.0
ストロンチウム	Sr(NO <sub>3</sub> )g	$28.2(0.1^{\circ})$	40.7	47.2(35*)	48.3	49.2	51.2(105*)
	TINO <sub>X</sub>	3.76	8.72	17.33	31.55	52.6	80.54
	Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	45.5	35.5	62.0	64.5	67.5	71.2
-ナトリウム	NaNOs	41.9	46.0	/102gml	10200		62.39(94*)
	Pb(NO <sub>2</sub> ),	38.8	36.5	75	95	115	138.8
	Ba(NO <sub>1</sub> ).	4.72	8.27	12.35	16.9	21.4	25.6
水酸化カリウム	KOH	49.2	52.8	58.03		61.73	65.15
一カルシウム	Ca(OH) <sub>7</sub>	0.143	$0.129(25^{\circ})$	0.107	0.0917	0.0800(70*)	0.0523(99*)
ナトリウム	NoOH	29.6	52.2	56.3	63.5	75.8	78.5(110')
A0101A	Ba(OH) <sub>2</sub>	1.65	3.74	7.60	17.32	50.38	Cellin Street
炭酸カリウム	E <sub>2</sub> CO <sub>1</sub>	51.25	52.5	53.9	55.9	58.3	60.9
本面カリウム	KHCO <sub>3</sub>	18.6	25.0	31.3	37.5		
水素ナトリウム	NaHCO <sub>3</sub>	6.48	8.72	11.29	14.10	19.1	
	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	6.54	18.1	32.8	31.6	31.1	30.9
チオ硫酸ナトワウム	Na <sub>1</sub> S <sub>2</sub> O <sub>1</sub>	33.40	41.20	55.33(45*)			1.000
(電力和工業者の行上)	K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.6	12.2	26.0	46.5	70	97
論大学に正言語語と	K <sub>i</sub> Fe(CN) <sub>4</sub>	23.22(0.17)	32.80(25*)	37.22	41.10(587)	45.27	47.60(99°)
ホウ銀	H <sub>2</sub> BO <sub>2</sub>	2.70	4.65	8.17	12.96	19.06	27.53
ホウキ	NaiBeOr	1.18	2.58	6.00	14.82	19.88	28.92
Empro-	AIK (SO <sub>4</sub> ) <sub>T</sub>	3.0	5.9	11.70	24.75	71.0	119.0(92.5°)
ヨウ化カリウム	KI	56.0	59.0	61.6	63.8	65.7	67.4
ナトリウム	Nat	61.54	61.1	67.2	72.0	74.7	75.14
徒骸アルミニウム	Al:(50 <sub>1</sub> ) <sub>3</sub>	27.50	27,82(257)	28.8	31.0	37.4 (80.6*)	43.90(99.2*)
アンモニウム	(NEL)SO4	41.35	42.85	44.7	46.64	48.47	50.42
一重約	ZaSO <sub>8</sub>	28.58	36.65(25*)	41.2	42.98	39.2(85')	37.7
	K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	7.20	10.0	12.9	15.4	17.1	19.4
	CdSO <sub>4</sub>	75.5	76.4	78.4	83.7	67.5(79*)	58.4(99")
カルシウム*	CaSO <sub>4</sub>	0.1759	0.2080(25*)	0.2097	0.2009(55*)	0.1847(75*)	0.1619
	FeSO <sub>1</sub>	13.6	20.8	28.6	35.5	30.4	24.0
	CuSO <sub>4</sub>	12.3	16.8	22.3	28.5	35.9	43.5
ナトリウム*	Na <sub>S</sub> O <sub>1</sub>	4.5	19.0	48.3	45.2	43.2	42.2
-==>7.1.(11)*	NiSO <sub>4</sub>	27.6	38.0	47.9	56.4	66	78
-マグネシウム	MgSO <sub>4</sub>	18.0	25.2	30.8	35.3	35.8	33.5
リン酸二水素ナトリウム	NaH <sub>2</sub> PO <sub>5</sub>	36.5	45.5	57.0	65	68	71
リン微水素二ナ1-105ム*	Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	1.6	7.7	52.7	82.8	93.5	103.3
リン酸三ナトリウム*	NaiPO <sub>4</sub>	5.38	14.53(25')	23.3	46.2	68.0	94.6

表 2-1 無機物の水に対する溶解度(続き) [1]

表 2-2	塩化ナ	$\mathbb{P}$	IJ	ウム	とホワ	ウ酸の	溶解度
-------	-----	--------------	----	----	-----	-----	-----

9	NaCl	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	$H_2O$
Amount	20.00 g	20.00 g	25.00 g
Maximum concentration	13.7 mol/kg	12.9  mol/kg	
423 K	7.23 mol/kg (Saturated concentration)	12.9 mol/kg*2	1
373 K	6.71 mol/kg (Saturated concentration)	6.15 mol/kg (Saturated concentration)	
298 K	6.14 mol/kg (Saturated concentration)	0.93 mol/kg (Saturated concentration)	

\*1 Three solutions with the same amount of H<sub>2</sub>O were prepared: 20.00 g NaCl and 20.00 g H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in 25.00 g H<sub>2</sub>O (as a NaCl-H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> solution); 20.00 g NaCl, in 25.00 g H<sub>2</sub>O (as a NaCl solution); 20.00 g H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> in 25.00 g H<sub>2</sub>O (as a H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> solution).

\*<sup>3</sup> At 423 K, the maximum concentration (12.9 mol/kg) of H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> is lower than the saturated concentration (19.4 mol/kg).



図 2-1 各種硫酸カルシウム(石こう)の溶解度



図 2-2 塩化物共存溶液に対する二水硫酸カルシウム(石こう)溶解度

#### 3. 燃料バンドル除熱性能

本章では塩水自動採取装置と差圧計測方法の改良と、短尺バンドルを用いた 沸騰濃縮試験について述べる。

#### 3.1. 塩水採取システムの改良

昨年度に製作した塩水自動採取システムは、バンドル試験体中の溶液を少量 抽出し、超純水により一定の倍率で希釈して試料を採取する装置である(図 3-1参照)。試料の採取は1時間毎に行い、約3日間連続して行えるようにバイ アル自動切換ユニットには計72本のバイアル瓶が設置できる仕様である。当 該装置は連続的に自動運転するための独自ソフトウェアを製作した。既存の塩 水自動採取システムの構成を以下に示す。

(1)送液バルブ

ポート数	:6ポート(ロータリー)
バルブ駆動方式	:小型電動型
材質	: ステンレス、PEEK 材
接続口	: 1/16 inch

(2) シリンジポンプ

シリンジサイズ : 0.5 μL~60 mL (任意で選択可能) 最少フローレート: 1 μL/s以下 最大フローレート: 100 μL/s以上 自動プログラムにより制御できる

- (3) バイアル自動切換えユニットサンプル数 : 72本
- (4)塩析出防止ヒータ
   形状 : 紐状型ヒータ
   設定可能温度 : 100 ℃以上

制御 : 温度制御コントローラーによる

- (5) コントローラー
   上記「送液切替バルブ」「バイアル自動切換ユニット」を制御(手動操作)し、「温度調整コントローラー」を内蔵している。
- (6)制御ソフトウェア
   コントローラー(温度調整を除く)及びシリンジポンプの操作をプログ
   ラム上で自動化するためのソフトウェア。予め各種装置の動作を入力し、
   繰り返し行うことが可能。
- (7)純水タンク

特殊ボトルキャップ付きねじ口瓶

容量 : 150 mL

接続口:1/16 inch

(8) ドレンタンク

特殊ボトルキャップ付きねじ口瓶

容量 :約 250 mL

接続口:1/16 inch

(9) 各装置接続配管等

SUS316及びテフロンチューブ

本年度は、海水が沸騰濃縮された場合や五ホウ酸ナトリウム溶液が低温部で 粘性が高くなることに対応すべく、改良を行う。このため塩水採取システムの シリンジを従来の樹脂製から温度を調整しやすいステンレス鋼製に変更し、周 囲にヒータを巻いて自動制御することにより採取元の温度と同じになるように 温度調整する。またサンプリング経路も同様に断熱保温や温度調節し、温度変 化を抑制する。改良の効果が得られることを試験流体である人工海水および五 ホウ酸ナトリウム水和水を用いて確認する。

以下に当該システムの改造項目を列挙する。

(1) シリンジポンプの改造

図 3-2 に改造に用いたステンレス製マイクロシリンジを示す。シリンジ ポンプへの換装が可能である。また、ステンレス製シリンジにも紐状 ヒータを設置してサンプリング全域に亘って±1℃以下の温度調整を可 能とした。

ポンプ型式 : ネクサス 6000 シリンジサイズ : 5 mL (ステンレス製) 最少フローレート: 0.0019 mL/h 最大フローレート: 19.3 mL/min PC のプログラムによる自動制御が可能

(2) 制御ソフトウェア (PC インストール)

コントローラー(温度制御は除く)及び交換したシリンジポンプの操作 をプログラム上で自動で行うためのソフトウェアである。予め各種装置 の動作時間を入力し、各動作の繰り返し回数を設定することができる。

バンドル試験体中の溶液を模擬した以下の試料溶液を当該システムにより採 取し、採取した試料の容量および試料溶液の塩濃度を計測した。

①五ホウ酸ナトリウム水和水 100 ℃飽和溶液(約 51 wt%)

②人工海水 100 ℃飽和溶液(約 38 wt%)

試料溶液の塩濃度は導電率で評価した。導電率の測定は、HANNA 社製 Dist7 を使用した。本測定器は、測定に必要な試料量が3mLと少量であるため採用した。

図 3-3 に五ホウ酸ナトリウム水和水濃度と導電率との関係を示す。図中には 100℃における溶解度(51 wt%)の水溶液を純水で希釈した倍率を示している。純 水を含めて、6 点のデータは濃度と導電率が比例関係にあることを示している。

図 3-4 に人工海水濃度と導電率との関係を示す。図中には 100 ℃における濃度(38 wt%)の水溶液を純水で希釈した倍率を示している。純水を含めて 4 点の データは濃度と導電率が比例関係にあることを示している。

続いて自動採取装置の機能検証を行った。試料採取間隔を30分に設定し

て、各々の模擬溶液について 72本の試料採取を実施した。電子天秤には島津 製作所の EB-3200D を使用した。

表 3-1 に五ホウ酸ナトリウム水和水の自動採取結果を示す。採取の基準量 5g に対してサンプル採取量は 5.39gから 5.69gの変動幅であった。平均値は 5.56 g であった。また、導電率から換算した塩濃度については基準値 0.51 wt%に対して採取サンプルの濃度は、0.48 wt%から 0.52 wt%の変動幅で平均値は 0.50 wt%となり、ほぼ基準値に近い濃度となった。

表 3-2 に人工海水の自動採取結果を示す。採取の基準量 5gに対してサンプル 採取量は 5.51 g から 5.66 g の変動幅で、平均値は 5.59 g であった。また、導電 率から換算した濃度については基準値 0.38%に対して採取サンプルの濃度は、 0.36 wt%から 0.39 wt%の変動幅で平均値は 0.38 wt%となり基準値と良い一致を 示した。

本試験により、改良した塩水自動採取システムにて定量的な採取と希釈が可能であることを確認した。



図 3-1 塩水自動採取システムの概念図

#### マイクロシリンジボンプ



#### ■ネクサス0000(両田注入/吸引)

第カモーターを搭載し、高融保障液の逆液に通したハイパワーモデルです。1本の大容量シリンクが使用でき、注入/吸引の切着が可能です。最大は本まで一気に処理可能なま<u>りり入り000 4本価セット</u>や高速速流に通した専用の<u>ステンレスシリンジ</u>もあります。運営モードの 詳様は<u>二56</u>をご参照くたさい。

住耕		70~1~1月23		
コード部号	CX81070	シリングサイズ	8/000-b-F	使大フローレート
シリンジサイズと本計	0.5 ptL-200eL×1#	0.5 g L	0.0001 // 1./14	1.43111/31
■転長→ド	高庄主入/吸引	tet	0.0002 # 1.49	295111/卅
最空2日~レ~ト	お食学課	1.11	0.0005 / 1.94	19101/9
長大 フローレート	お豊歩税 00462m/3.4-17	6.0%.	0.0015 #1.75	14年412/分
駆動力(水平方向)	200kg	10 #1.	0.00.01 #L/時	222312分
illigen.	+3~+4010(温度20~-8096)	25.p.L	0.0072 µ L/19	1460L/H
947	W27 × 020 × H16cm	80.srt.	0.0144.01.194	148.011/57
21	8.8Hg	100 gr L	0.0290 g L-14	200.01./分
入力電源	A0180240V 58/60Hz	290 g t.	0.0716 # 1.19	140 BL/#
電源コード長	1.7em	500 g L	0.1445.01.199	1407.012/分
種應	#0.39% #0.09%	tet.	0.0803wL/9	3.01mL/9
A 10.		3mi_	0.0011mL/#	11.2mに/分
お田(小村の市町)ます	あた 教師とは上島・主要/おまい	trai_	0.0019wL/9	18.3mL/7
シリンジれよび接援チューフ	ので、ものには「カニュー」ではないません。	tiferal.	0.0029mL/9	38.3mL/33
シリンジは住民していません	44	20ml.	0.0002wL/98	\$3.0mL/52
		30mL	0.0070eL/9	72.1mL/3*
		BOrni.	0.0107wL	TIONL 9
		100mil.	0.016HeL-9	170mL/9
		140ml	0.0200mL/9	206mL/97

 200ml
 0.0411mL/特
 425mL/分

 参考
 0.0001.01.00.01mL.00.00mL.00.001
 425mL/分

 少りシックや研練サューブラインにより詳細があります。
 1
 1

シリンジサイスはシリンジメーカーにより異なり、保証するものではありません。平知品は確定用にはご使用になれません。

#### 図 3-2 改良に用いたステンレスマイクロシリンジポンプ



図 3-3 五ホウ酸ナトリウム水和水濃度と導電率の関係





採取試料瓶	試料総重量	瓶重量	試料液測定	実測導電率	換算濃度	
ラベル番号	瓶含(g)	(g)	重量(g)	(µS)	(%)	
1	13.65	8.26	5.39	1295	0.518	
2	13.78	8.39	5.39	1290	0.516	
3	13.79	0.39	5.40	1266	0.520	
	13.78	8.36	5.40	1200	0.500	
6	13.77	8.36	5.41	1217	0.487	
7	13.78	8.36	5.42	1242	0.497	
8	13.86	8.42	5.44	1267	0.507	
9	13.86	8.42	5.44	1247	0.499	
10	13.82	8.37	5.45	1230	0.492	
11	13.80	8.35	5.45	1263	0.505	
12	13.83	8.35	5.48	1283	0.513	
13	13.79	8.32	5.47	1275	0.510	
14	13.78	8.27	5.51	1293	0.517	
15	13.89	8.37	<u> </u>	1202	0.505	
17	13.85	8.36	5.49	1290	0.310	
18	13.91	8.39	5.52	1233	0.493	
19	13.91	8.38	5.53	1243	0.497	
20	13.92	8.40	5.52	1242	0.497	
21	13.91	8.41	5.50	1246	0.498	
22	13.92	8.40	5.52	1243	0.497	
23	13.84	8.31	5.53	1252	0.501	
24	13.84	8.31	5.53	1246	0.498	
25	13.90	8.38	5.52	1255	0.502	
26	13.84	8.31	5.53	1233	0.493	
27	13.94	8.42	5.52	1231	0.500	
28	13.92	8.38 9.40	5.52	12/0	0.010	
30	13.95	8.40	5.53	1250	0.492	
31	13.85	8.33	5.52	1220	0.488	
32	13.83	8.32	5.51	1307	0.523	
33	13.90	8.36	5.54	1238	0.495	
34	13.90	8.37	5.53	1250	0.500	
35	13.88	8.34	5.54	1270	0.508	
36	13.95	8.39	5.56	1258	0.503	
37	13.88	8.32	5.56	1278	0.511	
38	13.92	8.34	5.58	1308	0.523	
39	13.93	8.34	5.59	1301	0.520	
40	13.94	0.33	5.01	1289	0.010	
41	13.90	0.37	5.61	1231	0.492	
42	13.98	8.36	5.62	1202	0.513	
40	14.00	8.38	5.62	1249	0.500	
45	13.98	8.36	5.62	1300	0.520	
46	14.00	8.38	5.62	1203	0.481	
47	13.97	8.37	5.60	1226	0.490	
48	13.94	8.30	5.64	1209	0.484	
49	13.98	8.34	5.64	1284	0.514	
50	14.02	8.38	5.64	1254	0.502	<b>最小</b> 重量
51	14.05	8.42	5.63	1194	0.478	5.39
52	14.00	8.39	5.67	1234	0.494	<b>是十</b> 番旱
53	13.97	0.32	5.00	1217	0.487	取入里里
55	13.98	0.40 8.33	5.65	1210	0.467	5.09
56	14.01	8.36	5.65	1283	0.513	平均重量
57	14.01	8.36	5.65	1204	0.482	5.56
58	14.01	8.36	5.65	1280	0.512	
59	14.01	8.35	5.66	1259	0.504	
60	14.08	8.39	5.69	1240	0.496	
61	14.02	8.35	5.67	1215	0.486	<b>—</b> ·
62	14.03	8.35	5.68	1269	0.508	最小濃度
63	14.06	8.38	5.68	1213	0.485	0.48
64	13.96	8.30	5.66	1254	0.502	里卡迪萨
65	14.05	<u>8.3/</u> 9.27	5.08	1201	0.500	取入 <b>辰</b> 度
67	14.04	8.37	5.07	1203	0.505	0.52
89	14.00	8 4 2	5.66	1200	0.010	亚均漕由
69	13.98	8,30	5.68	1265	0.506	0.50
70	14.03	8.34	5.69	1264	0.506	
71	14.06	8.37	5.69	1263	0.505	
72	14.00	8.32	5.68	1261	0.504	

表 3-1 五ホウ酸ナトリウム水和水の自動採取結果

採取試料瓶	試料総重量	瓶重量	試料液測定	実測導電率	換算濃度	
ラベル番号	瓶含(g)	(g)	重量(g)	(μS)	(%)	
1	13.79	8.26	5.53	2659	0.372	
2	13.97	8.39	5.58	20/8	0.375	
3	13.90	0.39 8.38	5.57	2004	0.370	
5	13.93	8.36	5.57	2699	0.378	
6	13.93	8.36	5.57	2657	0.372	
7	13.92	8.36	5.56	2604	0.365	
8	13.97	8.42	5.55	2662	0.373	
9	13.97	8.42	5.55	2672	0.374	
10	13.95	8.37	5.58	2659	0.372	
12	13.93	8.35	5.58	2680	0.375	
12	13.95	8.30	5.58	2703	0.378	
14	13.86	8.27	5.59	2626	0.368	
15	13.96	8.37	5.59	2726	0.382	
16	13.99	8.40	5.59	2757	0.386	
17	13.95	8.36	5.59	2788	0.390	
18	13.99	8.39	5.60	2638	0.369	
19	13.98	8.38	5.60	2604	0.365	
20	14.00	8.40 8.41	5.00	2724	0.301	
22	13.99	8.40	5.59	2760	0.386	
23	13.91	8.31	5.60	2709	0.379	
24	13.92	8.31	5.61	2700	0.378	
25	13.98	8.38	5.60	2734	0.383	
26	13.92	8.31	5.61	2718	0.381	
27	14.01	8.42	5.59	2755	0.386	
28	14.01	8.38	5.63	2734	0.383	
30	14.01	8 41	5.63	2644	0.385	
31	13.95	8.33	5.62	2623	0.367	
32	13.93	8.32	5.61	2696	0.377	
33	13.98	8.36	5.62	2678	0.375	
34	13.98	8.37	5.61	2684	0.376	
35	13.96	8.34	5.62	2708	0.379	
36	14.02	8.39	5.63	2699	0.378	
38	13.90	8 34	5.65	2604	0.365	
39	13.99	8.34	5.65	2662	0.373	
40	13.99	8.33	5.66	2672	0.374	
41	13.96	8.37	5.59	2659	0.372	
42	13.98	8.39	5.59	2680	0.375	
43	13.95	8.36	5.59	2703	0.378	
44	13.90	8.38	5.58	2/38	0.383	
45	13.95	8.30	5.57	2673	0.308	
47	13.93	8.37	5.56	2642	0.370	
48	13.88	8.30	5.58	2656	0.372	
49	13.92	8.34	5.58	2638	0.369	
50	13.96	8.38	5.58	2758	0.386	最小重量
51	14.00	8.42	5.58	2654	0.372	5.51
52	13.98	8.39 8.22	0.09 5.60	<u>∠048</u> 2622	0.371	<b>墨</b> 大
54	14.05	8 46	5.50	2022	0.381	取八里里 566
55	13.92	8.33	5.59	2656	0.372	0.00
56	13.95	8.36	5.59	2654	0.372	平均重量
57	13.93	8.36	5.57	2645	0.370	5.59
58	13.96	8.36	5.60	2663	0.373	
59	13.93	8.35	5.58	2610	0.365	
60	13.98	8.39	5.59	2043	0.370	
62	13.94	8.35	5.50	2673	0.330	最小濃度
63	13.90	8.38	5.52	2686	0.376	0.36
64	13.81	8.30	5.51	2631	0.368	
65	13.90	8.37	5.53	2686	0.376	最大濃度
66	13.90	8.37	5.53	2681	0.375	0.39
67	13.88	8.34	5.54	2690	0.377	<b>亚梅迪</b> 萨
80	13.98	<u>8.43</u>	5.55	2083	0.376	半均 <b>辰</b> 度 0.38
70	13.00	8.30	5.56	2639	0.369	0.00
71	13.91	8.37	5.54	2641	0.370	
72	13.84	8.32	5.52	2681	0.375	

### 表 3-2 人工海水の自動採取結果

#### 3.2. 差圧計測法の改良

試験対象である海水やホウ酸水は沸騰濃縮することで密度が増大する。差圧 を計測する際に、差圧導管内にも同じ流体が存在するため、対流や拡散により 導管内の密度が変化する可能性がある。密度の変化は水頭を変化させることか ら、差圧計測値に影響を及ぼす。

本節では、正確な差圧を計測するために、試験体に繋がる差圧導管を水平に 維持し、水平部にシリコーンを封入することで溶質の拡散を抑制するように改 良する。その後に溶質の拡散がないことを確認する。

図 3-5 に製作した計装配管継手の構造図を示す。外形寸法は幅 100 mm、奥行 50 mm、高さ 65 mm で、材質はアクリルである。出入口接続孔間を凹凸流路構 成とし、上部凸部に隔離液を封入する。凹凸流路は、上下左右 φ 5mm の孔加工 にて形成し、穴加工の不要な箇所は閉塞栓を取り付けた。接続孔は PT1/8 ねじ 込である。拡散を防止するためのシリコーン液はモーメンティブ・パフォーマ ンス・マテリアルズ社の Element14\*PDMS 10-JC を用いた。動粘性係数 10 mm<sup>2</sup>/s のシリコーンである。

接続に際してはバンドル試験体近傍の計装管接続部を外し、製作した計装管 継ぎ手を試験体のアルミ架台に据付固定し、計器側計装管を接続復旧した。差 圧計導管内の溶液封入手順は以下の通りである。

- (1) 境界調整孔の閉止栓2箇所を外す。
- (2) 差圧計側より計装管を水封入する。
- (3) 計装管エア抜きを行う。
- (4) 計器側止弁を閉じる。
- (5) 試験体側計装管のエア抜きを行う。
- (6) 試験体側止弁を閉じる。
- (7) 境界調整孔2箇所を閉止する。
- (8) エア抜き孔止弁を開く。
- (9) 閉止栓を外してシリコーンを封入する。
- (10)エア抜き/封入孔を閉じる。
- (11)計装管継手出入口止弁を開く。

改良した差圧計導管改良部の塩分拡散防止効果の確認を行った。図 3-6 差 圧計導管改良部の塩分拡散防止効果確認試験の様子図 3-6 に試験の様子を示す。 試験体側の溶液は人工海水である。水頭圧を加えるために、鉛直配管には高さ 450 mmに人工海水を充填している。それより下流側(実際の測定においては差 圧計側)にはシリコーン油を注入した。シリコーン油の動粘性係数は 10 mm<sup>2</sup>/s である。塩分濃度計にはアタゴ製 PAL-41S を使用した。

表 3-3 に塩分濃度試験結果を示す。試験に使用した人工海水は海水濃度より 濃く、4.3 wt%とした。試験開始時にシリコーンを境に試験体側で計測した濃度 は4.2 wt%、差圧計側では0.0 wt%であった。170h後に同じ場所から計測した濃 度は、試験体側では4.3 wt%、差圧計側では0.0 wt%であった。

本試験結果から、塩分の拡散は防止できたと言える。

表 3-3 塩分拡散防止効果試験における塩分濃度測定結果

時期	測定時刻	試験体側濃度	差圧計側濃度	周囲温度
試験開始時	0 h	4.2 wt%	0.0 wt%	7 °C
試験終了時	170 h	4.3 wt%	0.0 wt%	7 °C



図 3-5 計装配管継手の構造図



図 3-6 差圧計導管改良部の塩分拡散防止効果確認試験の様子

#### 3.3. 沸騰濃縮試験と析出塩のX線CT撮影

本節では、海水が注入された原子炉燃料模擬バンドル流路における塩析出試 験の分離効果試験として、短尺バンドルを用いた沸騰濃縮試験を実施する。試 験後の短尺バンドルの析出塩を X 線 CT 撮影し、沸騰条件とバンドル試験体内 の塩析出量、析出位置との関係性を見出す。

#### 3.3.1. 短尺バンドル試験装置

使用する短尺バンドル試験装置の概要を述べる。まず、本試験における ヒータバンドルの基本仕様は以下の通りである。

- o 設計圧力 0.2 (MPa)
- o 設計温度 200 (℃)(常時ロッド表面温度)
- o ロッド温度 600 (℃)(最大上昇温度)
- o 主要材質 耐腐食材(被覆管材は NCF600 相当品)
- o 使用流体 海水

試験装置は、可視化容器に5×5バンドルが組み込まれた短尺試験体、下降配 管(模擬配管)、凝縮タンク、試験体電源、及び溶液タンク、廃液タンク等から 構成される。図 3-7 に装置の概略構成図を示した。

短尺試験体は、発熱長が短い電気加熱のヒータロッドをスペーサで5×5正方 格子に束ねた5×5バンドルを試験容器に挿入されたもので、ヒータロッドへの 上部はOリングシールにて大気へ引出して給電している。

短尺試験体への給水は、飽和水溶液を所定液位に一定維持の下降管下部と短 尺試験体下部との配管接続にて U 字管流路とすることで、短尺試験体の通電加 熱により沸騰状態の液位を所定に維持する構成としている。下降管内溶液の温 度は、管側面にヒータを巻付けて加熱することで、飽和温度近傍にて温度維持 している。また、短尺試験体内の液位は、下降管液位をポンプ給水にて所定液 位に調整することで一定に維持している。

短尺試験体で発生した蒸気は、市販タンク底部に蒸気放出コイルを内蔵させた凝縮タンクへ放出して冷却する。凝縮タンク上部にはドーナツ状スプレイ ヘッダーを配置し、スプレイノズルにて冷却水を散水している。

試験バンドルでの主な計測は、ロッド表面温度、バンドル流路圧力、ダウン カマ液位、流体温度等である。



図 3-7 短尺バンドル試験装置の概念図

試験に用いる短尺燃料バンドルの仕様を下記に示した。図 3-8 に短尺バンド ルのロッド配列、概略形状を示した。また、図 3-9 にヒータロッドの形状寸法 を示した。

- o バンドル構成 5×5 正方格子配列
- o バンドル出力 最大 50 kW (単相 AC200 V印加時)
- o ロッド形状寸法 外径; φ10mm、発熱長; 530mm
- o 出力分布 軸方向;一様分布、径方向;一様分布
- o 模擬チャンネル 矩形チャンネル(□68.3mm/コーナーR8mm)
- o スペーサ 丸セルスペーサ模擬(有効発熱部1個)
- o その他 バンドル下部にロッド位置決めの支持孔を形成

電源供給及び熱電対はバンドル上部端より引出す

試験バンドルの所定のロッドにおいて、ロッド表面に熱電対を埋め込み温度 計測が出来るものとし、図 3-8 に熱電対埋め込みの計装ロッドの配置、及びバ ンドル軸方向での温度計測位置を示した。

- o 温度計装ピン配置 バンドル内に5本配置
- o 温度計測数 最大2カ所/ロッド
- o 計測位置 発熱端部、スペーサ内

図 3-10 に短尺バンドル試験体の全体組立図を示した。表 3-4 に、図 3-10 の部 品番号の名称、概略仕様を示した。可視化容器の仕様は以下の通りである。

- o 設計圧力 0.2 MPaG
- o 設計温度 120 ℃
- o 形 式 縦型矩形管
- o 内幅寸法 68mm x 68mm -0/+0.3 mm 以下
- o コーナー形状 R9 mm +0/-1 mm
- o 長 さ 全 長 800 mm

 
 o 流路管接続 JIS5K 異型フランジ接続/印篭形状/芯出しピン取付 フランジ間シールは0リングシール構造

o 接続孔流入孔25A-PT1 ネジボスx1 カ所ドレン孔15A-PT1/2 ネジボスx1 カ所

オーバーフロー孔 20A-PT3/4 ネジボス x2 カ所

(上部フランジ下面位置)

o 計測孔 ボス形状 穴径 2mm/ISO 管用 PF1/8 ボス取付(0 リングシール)

差圧2カ所(計測スパン350mm)

温度2カ所

- o スペーサ
  - 形 式 丸セルスペーサ(5x5正方格子)
  - 内幅寸法 66.0mm x66.0mm xH30mm

個数

- 板厚 セル厚;約0.4mm、バンド厚;0.5mm
- ・ 材 質 SUS 材にて製作、組立後全面テフロンコーティング
- ・ 製作数 1個
- o 容器底板
- 形状寸法 JIS5K-100A 閉止フランジ(RF) x 厚さ 25~30mm
   接続 0 リングシール構造
- ロッド支持孔 フランジ上面に 5x5 正方格子配列のロッド端栓差し込み孔
   差し込み孔 7x7mmx 深さ 10mm
   孔配列 13x13mm ピッチにて 25 個(縦列;5/横列;5)
   (5x5 格子配列の差込孔は中心振分けにて配置)
- ・ 排水孔
   PT1/4 ネジ穴/六角穴付閉塞栓取付)
- o フランジボルト締付面は、二つ割り半月形状当て板を用いてボルト締付
- o 材 質 ポリカーボネイト
- o 製作数 3体

上部接続管の仕様を以下に示す。

- o 形 式 薄肉円筒管
- o 形状寸法 約 69mmx 69mmx 長さ 200mm (コーナー部 R8 以下)
- o 接続形式 下端部 JIS5K-;100A-RF 接続

(印篭接続にて芯だし構造)

下端部 T字管を接続にて上端は閉止板(□69mm 穴)溶接

(周囲にシール板締のボルト穴)

シール板 0リングシール板、0リング押え板

(シール板/押え板のボルト穴は上下千鳥配置)

0	上部流路管	形状寸法 約 69 mm x 69 mm x H70 mm(テフロンコーテ	イング処理)
		流路管取付 模擬チャンネル/上部接続管接続	間に挟込
		上下部フランジ面は0リングシール。	
0	接続孔	蒸気放出孔 50A-PT2 ネジユニオン取付	x1 カ所
		計装線取出 穴径 50 mm ボスを溶接にて取付	x2カ所
		0 リングシールの閉止板取付(PT1/4 ネジ孔 x3)	個付)
		均圧孔 20A-PT1/2 ネジボス	x1 カ所
0	その他	計測孔 穴径2 mm/IS0 管用 PT1/8 ボス取付	x2カ所
		エア抜き孔 上端部位置に PT1/4 ネジのボス	x1 カ所
		流路管下端より30 mm上の管側面に排出孔(φ	15 mmx32 個)
0	材 質	本体 SUS304 にて管内面はテフロンコー	ーティング
		シール部材 ポリカーボネイトにてテフロンコ	ーティング
0	製作数	3 基	

下降管の仕様を以下に記載する。

0	形	式	円筒縦型				
0	形状寸	法	内径約φ100mm	х	H850	mm	
0	接続形	式	上端部	JIS	S5K-10	00A-RF 接続構	造

下端部	100A-付合わせ溶接キャップ

o 容器形構造

	• 容器接続孔	均圧接続孔 2	20A-PT3/4 ネジ込ボス	
		バンドル接続	25A-PT1 差込み溶接	
		溶液供給孔 1	.0A	
	・ 加熱ヒータ	容器下部胴部	マイクロヒータ巻付(約10m)/AC	200-2kW
			表面温度熱電対取付(2	カ所)
	• 計測孔	流体温度	PT1/4 ネジボス x1 プ	り所
		液位差圧	PT1/4 ネジボス(500 mm) x2 カ	り所
0	材 質	SUS304	(下部シール板はポリカーホ	「ネイト)
0	製作数	1基		

(1) 凝縮タンク

0	形	式	円筒縦型	
0	概略形料	犬	市販ドラム管を追	加工にて使用(φ550mm x H850 mm)
			(容器上端部に上語)	蓋締付固定のフランジ取付)
0	タンク_	上蓋	形状寸法 φ600	mm x t5 mm(SUS)
			蒸気放出孔	JIS5K-50A フランジ(上蓋に固定)
			50A-SU	IS 管接続にてタンク内上部で支持固定
			大気開放孔	80A-塩ビ管エルボ端部に JIS5K-FF 取付
			その他 エア抜	き排出孔 ; 10A-PT3/8 ネジ込ボス
0	スプレイ	イヘッダー	・ タンク内上端部	に取付
			形状寸法	管径 32A x φ500 mm
			スプレイノズル	φ5 mm x 6箇所(PT ネジ込)
0	冷却コイ	イル	$\phi 450$ mm x 200 t	<sup>°</sup> ッチ x 5 巻の薄肉管
			(コイル内側に蒸気	気放出孔φ10 mm x 30箇所)
0	接続孔	(1	)スブレイ水ノズル	;15A x 1 箇所
		2	)ドレーン・排水	; 32A x 1 箇所
		(3	)オーハ゛ーフロー	; 32A x 1 箇所
		(4)	)給水孔	;15A x 1 箇所
0	計測孔	1	)液位計取付	; PT1/4 ネジボス x 2 箇所
			(計測範囲;700	mm、可視部;アクリル管、止弁取付)
		2	)温度計測	; PT1/4 ネジボス x2 箇所
0	換気フ	アン	屋外排気の簡易フ	アン及び簡易ダクトを取り付けた。
0	材 質		SUS304	

溶液タンクの仕様を以下に示す。

0	形 式	円筒縦型
0	形状寸法	φ560 mm x H600mm 上端部上蓋付
0	容器形状	
•	容器接続孔	凝縮管吐出し   25A-PT1.1/2 ネジボス
		戻り管接続 15A-PT1 ネジボス
		ドレーン孔 15A-PT1/2 ネジ(止め弁付)
	• 液位計	計測仕様 テフロン管;400mm/計測孔に止弁取付
	• 計測孔	温度計測 PT1/4 ネジボス x1 カ所

液位計測 PT1/4 ネジボス x2 カ所

(計測孔距離 400mm)

- ・ ヒータ
   上部上蓋に簡易型の投込みヒータ取付
   ヒータ容量 AC200V 単相-2kW
- o その他 市販 SUS タンクの追加工にて製作した。 管内壁はテフロンコーティングした。
  - (オーヨー(http://oyogkn.co.jp) ステンレス容器相当品)
- o 材 質 耐食材(SUS304相当品)
- o 製作数 1基

廃液タンクの仕様を以下に示す。

o 型 式 密閉丸型タンク(鉄枠付), 2000 相当品

㈱タクミナ http://www.tacmina.co.jp

- o 形状寸法 □750 mm x H600 mm, 2000 容器
- o 貯蔵液 塩水
- o 付属品 ドレン止弁
- o 接続ノズル 廃液挿入孔(φ100mm以上)x1カ所、給水孔(15A)x1カ所 排液孔(20A) x1カ所
- o その他 液位表示(本体付属)
- o 材 質 PVC(ポリ塩化ビニル)
- o 製作数 1基

洗浄タンクの仕様を以下に示す。

- o 形 式 円筒縦型
- o 形状寸法 内径約φ560mm x H600 mm 上端部上蓋付
- o 容器形状
- 容器接続孔 試験体戻り管 25A-PT1 ネジボス ポンプ吸込み 25A-PT1 ネジボス ドレーン孔 15A-PT1/2 ネジ(止め弁付)
   計測孔 温度計測 PT1/4 ネジボス x1 カ所 液位計測 テフロン管;400 mm 計測孔に止弁取付
- ・ ヒータ 上蓋に簡易型の投込みヒータ取付

(ヒータ容量; AC200 V 単相-2 kW)

o 材 質 耐食材(SUS304相当品)

- o 製作数 1基
- ・ 模擬チャンネルの軸方向には、下記仕様の内部溶液濃度を測定するための
   抽出孔を設けた。
- ・ 抽出孔形状 ISO-1/8 ネジ込ボス/抽出孔;φ2 mm
- ・ 抽出孔位置 図 3-12(C)に示す下降管 x2、配管 x1、試験体 x2 の計 5 箇所
- 抽出孔構造 図 3-12(A)に示す通り、スウェージロック(SS-400-1-2RT)
   の1/8インチオネジを使用してセプタム(ゴム製、アジレント製 5080-8728)
   を締め込む構造とした。
- その他 流入口配管(25A-Sch20-SUS304)および下降配管側面のサンプリングポートは、適切な配管材料(ティー/ブッシュなど)を用いて同様なレイアウトとし、保温材などを考慮して針先が約10mm液中へ出るようにした。
- 上部接続管の下部フランジには、試験体据付固定のための支持金具を取り 付けた。
- o 配管、保温

下降管と試験体管の接続配管、蒸気放出配管、及び排水管等の配管 施工している。下降管と試験バンドルとの配管は保温している。ま た、蒸気配管は火傷防止のため、保温した。

•	配管サイズ	下降管/試験/	バンドル		SUS-25A-s	ch40	
		蒸気管		C L	SS-50A		
・坟	1圧配管	SUS-10A					
		給水/排水	ブレー	ドホー	ス/15A~2	5A	
•	配管接続	試験バンドル	/ ユニス	オン接続	続、蒸気酢	己管はフレ	~キ管接続
		下降管	下部配管	音は差差	込み溶接、	上蓋はF	YT ネジ込
		凝縮タンク	JIS5K-2	B-FF			
•	その他	洗浄ポンプ	シリコン	/系ブ	レードホー	-スでポン	/プ及び
		試験体、洗浄	タンクと	と接続			
•	保温	下降管		下降管	本体及びつ	下部配管0	)保温

試験バンドル 上部接続管、蒸気配管の火傷防止 o 計装品取付、配線

計装品の導圧配管にはテフロンチューブを使用し、継手にはメイルタ
イプを使用した。計測取出し部は止弁を設けた。計装配線は装置架台に 簡易端子箱を取付け、内部に端子台を設けて計装品の配線施工した。

- 圧力計測 試験部上部圧力 ディジタル圧力計/PT1/8 ネジ
- 差圧計測 加熱部差圧 微差圧計/G1/8 ネジ

下降管液位 微差圧計/G1/8 ネジ

- 温度計測 試験バンドル K型シース熱電対(φ1.6mm) x 2 カ所 下降管表面 K型シース熱電対(φ1.6mm) x 2 カ所 下降管内温度 K型シース熱電対(φ1.6mm) x 2 カ所 接続配管温度 K型シース熱電対(φ1.6mm) x 2 カ所 凝縮タンク温度 K型シース熱電対(φ1.6mm) x 1 カ所
- o 排水
- 機器のドレンは、ブレードホースを用い、接続継手はリングジョイントを 用いた。
- o 電源配線
- ・ 短尺バンドルの電源は、付属の電源リード線を接続し、簡易架台下部位置
  に電源端子台を設けて接続した。
- 下降管のヒータ電源は、バンドルヒータ同様に、端子箱内に端子台を設けて接続した。





(a) バンドルロッド配列

(b) 軸方向熱電対位置





図 3-9 短尺ヒータロッド形状寸法図



図 3-10 短尺バンドル試験体の概念図

3	スペーサ ヒータロッド	2 f所 25 本	SUS304 NCF600	丸た模擬(テフロン被覆) る10x加熱長 530mm	16	下部ドレーン孔	1基	SUS304 SUS304	10A-PT3/8 ボパ JIS5K-50A/ d 6SUS 管 x5
4	ダミーロッド	25本	SUS304	↓ 10xL170mm_接続;M6	17	上部エア抜き孔	1式	SUS304	10A-PT3/8 # X
5	可視化升/>>科容器	1体	お助お科ト	<sup>D</sup> 68xL800mm/100A-FF	18	水位排水孔	2 個	SUS304	20A-PT3/4-非"ス
6	可視化容器底板	1枚	苏勃古科	JIS5K-100A- <sup>□</sup> 7x25	19	上部流路管	1個	SUS304	□68xL70mm/
7	上部容器	1個	SUS304		20	均圧接続孔	1個	SUS304	15A-PT1/2-#"ス
8	圧力シール板	1枚	SUS304	JIS5K-100A- <sup>□</sup> 65x 深 7mm					
9	0 リング押え板	1枚	SUS304	φ 120xt10mm-φ 9x25 穴					
10	上部出口孔	15所	SUS304	50A-PT2.1/2 ネジ					
11	ヒータ(+)極	25 本	Cu 導線	ヒータ付属/接続2*/9付					
12	ヒータ(-)極	25 本	Cu 薄線	ヒータ付属/接続コネクタ付					
13	流入孔	1 加所	胡加斯林	25A-PT1 ネジ		-			

表 3-4 短尺バンドル試験体構成部材の概略仕様一覧



図 3-11 5×5 バンドル試験スペーサの形状寸法



図 3-12 サンプリングポートの位置および構造

#### 3.3.2. X線CT撮影設備

X線 CT撮影は、株式会社光子発生技術研究所所有の装置(model MIC-RT) を使用した。表 3-5にX線撮影装置の仕様を示す。図 3-13に回転試料台及び放 射線検出器であるフラットパネルディテクタの写真を示す。回天試料台の上に 載せた短尺バンドル試験体が測定中に揺れないように固定するため、設置台と 短尺バンドル試験体の間に入れる台座を作成した。図 3-14に台座の制作図を示 す。

サンプルは、回転中心が撮影パネルから 450 mm の位置に設置し、バルブの 向きが図 3-15(上から視点)のようになるように設置した。バンドル本体に対 してバルブが図中では左上になるように 45 度回転した位置に配置した。図中上 部には X 線源を、下部には板状の撮影用のフラットパネルを記載した。一点鎖 線はターンテーブルの回転中心と X 線源中心とを結ぶ直線として示す。

図 3-16 に高さ方向の撮影範囲を示す。X 線 CT の高さ方向の撮影範囲は上部 と下部とで二分割されている。上部は図中に赤色で示す範囲で、最上部のバル ブから 20mm 上から下方に 282 mm の範囲とした。下部は図中に青色で示す範 囲で最下部バルブから 13 mm 下より上方に 282 mm の範囲とした。上部と下部 の範囲はスペーサ部にて 10 mm 重なり、上部と下部合わせて高さ 550 mm 以上 の視野(図 3-16 中の緑色矢印)を確保した。

水平方向には図3-16中に緑色矢印で示した範囲で、上部と下部共に310mm の範囲である。中点に回転中心が来るようにした。

X線の線量は、1秒露光で15000カウントになる線量とした。撮影データの 水平方向 230 mm を 1024 ピクセルにマッピングして CT 再構成を行った。再構 成画素の1ピクセルは一辺 0.225 mm の立方体となっている。

表 3-5 X線撮影装置の仕様

構成	仕様						
マニュピレータ	自動4軸構成(拡大軸・オフセット軸・昇降軸、回転軸)						
	高さ	500mm					
	直径	400mm					
	重量	100kg					
	り式 	16 inch	, , , ,				
	検山面 り 1 へ	200um					
		4茶サイム 200µIII 					
	山大批河	2040 X 2040 PIXE	2046 x 2046 pixel(有別回系2026 x 1828pixel)				
	山力酒詞						
 X線源	MIC6	5.5MV					
	コーンビーム						
撮影時間と分解能	サンプルサイズ	撮影時間	分解能	備考			
(例)	Φ156mm x H156mm	13分	78µm	最大倍率:2.5倍拡大撮影			
	Φ260mm x H260mm	13分	130µm	最小倍率:1.3倍拡大撮影			
CTシステム	画像の種類	透視画像·二次元CT画像·三次元CT画像·MPR画像					
	ROIの種別	短形·楕円·線分					
	ROIの計測	長さ・面積・角度・グレイ値の最大値、最小値、平均値、標準偏差					
		プロファイル表示・ヒストグラム表示					
	三次元画像処理システ	VGStudioMAX(コンプリートパッケージ)					
	ل ل	座標計測·設計值/測定值比較·肉厚検出解析					
		P201/VW50097欠陥/介在物解析					



図 3-13 X線CT設備の回転試料台とフラットパネル



図 3-14 X線CT撮影用の台座



図 3-15 上部から見た短尺バンドル撮影位置と向き



図 3-16 高さ方向の撮影範囲

#### 3.3.3. 沸騰濃縮試験手順

本項では前述の短尺バンドル試験体を用いた沸騰濃縮試験の手順を示す。本 試験における主な作業項目は、①試験前点検、②試験機器の起動、③試験溶液 の予熱、④試験液位設定、液位差圧計調整 ⑤バンドル試験体への注水、昇温 ⑥塩析出試験 ⑦バンドル試験体の洗浄 ⑧下降管の洗浄 である。各項目に ついて以下にその詳細を示す。

#### 試験前点検

短尺バンドル試験体を垂直に固定し、揺れ防止用板を取り付ける。下降管と バンドル試験体入口とを接続する。蒸気排出口等の必要配管を接続する。計測 のためロッド温度、溶液温度測定の熱電対、圧力計、差圧センサを接続する。 ヒータを端子番号に従い接続する。下降管とバンドル試験体の接続配管の弁

(BV001、BV002)、エア抜き弁(BV010、BV011)、均圧管止弁(BV009)は全開 にする。差圧計装弁 (BV003)、ドレン弁(BV006) は全閉にする。

実験機器の起動

配電盤の元電源を入れ、計装電源の電源(ELB)を入れる。次にヒータ電源を除く他の電源(ELB)を入れる。データ収録装置を起動し、データ収録状況を確認する。

試験溶液の予熱

溶液タンクに試験溶液である人工海水が 50 L以上保有されていることを確認 する。不足の場合は補充する。溶液タンクに備え付けのヒータ 2 台の電源ス イッチを入れ、温度調節器の設定温度 70 ℃にセットする。加熱されていること (溶液温度の上昇)を確認し、タンクの上蓋を閉じる。屋外凝縮タンクの配管の 接続状況、ポンプ、周辺の水漏れ等の不具合がないことを確認する。凝縮タン クの液位を約 60%に調節する。スプレー流量調節弁を約 50%に設定する。凝縮 ポンプを稼働させ、ポンプ吐き出し圧が 0.15 MPa 以上であることを確認する。

試験液位、液位差圧計の設定

試験液位に合わせて、制御の上下限の設定を行う。制御の上限値は設定値の

0.1 kPa 高くし、下限値は設定値より 0.2 kPa 低い値に設定する。試験部差圧計 (計測位置が大気接続になっている)を零に調整する。

#### 5 バンドル試験体への注水、加熱

溶液タンク内の人工海水温度が 70 ℃近傍になってから溶液タンクポンプ吸い 込み止弁を全開にし、液位調整ポンプを起動して試験設定液位の上限において ポンプを停止する。下降管入口の給水止弁の開度は 45 度程度に絞り、試験中の 急激な給水を緩和する。液位計表示値が設定液位を超え、警報表示の赤ランプ の点灯を確認し、ドレン止弁を開いて設定液位(容器に赤線表示)まで排水する。 微差圧計のディジタル値を読み、これを液位設定値として液位の上下限値を再 設定する。下降管温度調節計の設定温度を 90.0 ℃にセットし、液位調整ポンプ が ON 状態において下降管ヒータの電源を入れる。下降管水温が 90 ℃を超えた ら、設定温度を徐々に高め、最終的に 98 ℃にセットする。

⑥ 塩析出試験

以下の項目が試験条件に到達していることを確認する。

- ・下降管温度が約98℃で安定していること。
- ・溶液タンク内の人工海水の温度が約70℃で安定していること。
- ・下降管液位が実験液位の制御範囲内であること。

データ収録を開始し、バンドル試験体のヒータ電源を入れ、出力調整器を 操作して目標熱流束に調整する。電圧、電流は小刻みに変化するので、平均 値が所定の熱流束になるように調整する。バンドル試験体内の溶液の状態を 観察し、沸騰が開始した時点を試験の開始としてその時間を記録し、ストッ プウオッチで沸騰濃縮時間を計測する。試験中は定期的に以下の状態を監視 し、所定時間に溶液を採取する。

- ・液位低下により、液位調整ポンプが自動的に起動/停止し、一定液位を 保つこと。
- ・ロッド表面温度がほぼ一定温度であること。
- ・バンドル試験体のヒータの電圧/電流がほぼ安定していること。
- 下降管温度がほぼ一定で安定していること
- ・塩の析出状況やバンドルや下降管に漏れなどがないか観察すること

- ・データロガーの各測定値において急激な変化がないこと
- ・溶液の採取は基本的には試験開始時と試験終了時とする。2時間を超える実験条件については、試験時間の半分の時間の時点でサンプリングを行う。
- ・溶液の採取場所は、採取孔1~5とするが、条件によっては液面が採取孔 よりも低い場合がある。その場合は採取不可とする。

所定時間になった時点で以下の操作を行い、バンドル試験体は X 線 CT 観察 に提供する。

- ・所定時間にバンドル試験体のヒータと下降管ヒータの電源を切る。
- ・BV001を閉じ、BV003を開き、バンドル試験体内の溶液を抜く。
- ・データ収録を停止する。
- ・温度測定端子、圧力測定端子等計測端子を取り外す。
- ・各接続配管を外し止栓する。
- ・ヒータ端子を取り外し、まとめておく。
- ・バンドル試験体を架台から取り外し、台車に仮固定する。
- ・必要部位の観察、写真撮影を行う。
- ・X線CT測定位置に移動する。
- ⑦ バンドル試験体の洗浄

バンドル試験体下部の液流入口に洗浄ポンプの吐き出し口のパイプを取り付け、上部蒸気出口のユニオン接続部に洗浄タンクへの配管を取り付ける。洗浄 液温度が約 60℃であることを確認し、洗浄ポンプを起動させ、約 30 分間循環 させる。洗浄状況をよく観察する。30 分間の循環で清浄にならない場合はさら に時間を延長して、洗浄を継続する。目視で循環水による洗浄が完了したと判 断されたら、循環ポンプを停止し、バンドル試験体内に滞留する温水を抜く。 その後、更にイオン交換水を上部から注水し、バンドル試験体内部を洗浄する。 洗浄に際しては排水の塩分濃度が純水に近い値であることを確認した。その場 合であっても固着していることも考えられるため、初期の 2 回の実験では洗浄 後のバンドルの X 線 CT 撮影を行い、判別できる塩が存在しないことを確認し た。

## 下降管の洗浄

循環ポンプ吐き出し配管と下降管出口部を接続し、上部均圧管にホースを接続して洗浄タンクへの配管を確保する。循環ポンプを起動させ、バンドル試験体と同様に30分間下降管内部を洗浄する。

#### 3.3.4. 試験溶液

表 3-6 に、人工海水の組成を示す。本年度使用した人工海水はマリンアート SF-1 である。昨年度用いたダイゴ人工海水と比較しても主成分の違いは小さい。 本試験では、初期および沸騰濃縮中に注液する溶液は共に人工海水の 2.5 倍濃 縮とした。飽和温度における人工海水は 3 倍濃縮で硫酸カルシウムが析出する ため、それより十分低い濃度として 2.5 倍濃縮とした。1 kgのイオン交換樹脂を 通した水に、マリンアート 95 gを溶解させた溶液である。

原料名	構造式	マリンアート	ダイゴ人工海水
塩化ナトリウム	NaCl	22.1 g	20.747 g
塩化マグネシウム	$MgCl_2 \cdot 6H_2O$	9.9 g	9.474 g
塩化カルシウム	$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	1.5 g	1.326 g
無水硫酸ナトリウム	$Na_2SO_4$	3.9 g	3.505 g
塩化カリウム	KCl	0.61 g	0.597 g
炭酸水素ナトリウム	NaHCO <sub>3</sub>	0.19 g	0.171 g
臭化カリウム	KBr	96 mg	85 mg
ホウ砂	$Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$	78 mg	34 mg
無水塩化ストロンチウム	$SrCl_2$	13 mg	12 mg
フッ化ナトリウム	NaF	3 mg	3 mg
塩化リチウム	LiCl	1 mg	1 mg
ヨウ化カリウム	KI	81 µg	70 µg
塩化マンガン	$MnCl_2 \cdot 4H_2O$	0. 6 µg	0.8 µg
塩化コバルト	$CoCl_2 \cdot 6H_2O$	2 µg	0.2 µg
塩化アルミニウム	AlCl <sub>3</sub> • $6H_2O$	8 µg	8 µg
塩化第二鉄	$FeCl_3 \cdot 6H_2O$	5 µg	5 µg
タングステン酸ナトリウム	$Na_2WO_4 \cdot 2H_2O$	2 µg	0.2 µg
モリブデン酸アンモニウム	(NH)6M07O24 • 4H2O	18 µ g	20 µg

表 3-6 人工海水の成分

#### 3.3.5. 沸騰濃縮液の成分分析方法

沸騰濃縮試験中に抽出した溶液の成分を分析するために、昨年度導入したアジレントテクノロジー社のICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)装置7700Xを用いた。分析対象とする元素は、B, Na, Mg, S, Cl, K, Ca, Sr, Br とする。試験溶液の成分元素である。

図 3-12 に溶液の採取場所を赤字丸数字①~⑤として記載した。採取孔にはセ プタムを取り付けており、繰り返しの溶液採取に対しても漏洩を抑制できる。 しかしながら初期の実験においては、採取孔のセプタムがサンプリングの注射 針に詰まることが頻発し、サンプリングを困難にしたため、注射筒と注射針の 間にコックを設けて、注射針を常にサンプリングロに取り付ける構造に変更し て、閉塞の問題は解消した。液位が低い試験条件では、サンプリング孔①およ び⑤の位置が液面より低くなるため、溶液がサンプリングできないことがあっ た。なお、サンプリングは各条件の運転時間が終了する 5 分前から、①から順 に開始し⑤のサンプリング終了と運転時間終了がほぼ同時となるように実施し た。

ICP-MS 分析に用いる標準液は関東化学製 Na, Mg, Ca, Cl, Br, B, K, Sr 標準液 1,000 mg/L および SPEX 社製 S 標準液 1,000 mg/L を使用した。上記元素のうち、 Na, Mg, K, Ca, B, Sr は内標準法に従い定量化した。内標準は Be, Y 各 1 mg/L の 溶液をペリスタルティックポンプによるオンライン法で添加した。この条件で は内標準溶液と試料溶液での内標準物質のカウント比が約 16:1 となるため、 試料中内標準物質濃度は約 60 ng/L の測定を行ったことになる。試料の希釈及び 検量線の作成は 1 % 硝酸を用いた。Br, S, Cl は 0.25%水酸化テトラメチルアン モニウム(TMAH)水溶液にてアルカリ希釈して測定した。アルカリ溶液中での 内標準は、ばらつきが大きかったため、絶対検量線法にて測定を実施した。内 標準を用いないため、アルカリ分析時には低濃度、高濃度の 2 水準で添加回収 による精度の確認を行った。

#### 3.3.6. 沸騰濃縮試験パラメータ

表 3-7 に沸騰濃縮試験パラメータを示す。試験条件は、液位 3 水準、熱流束 3 水準、沸騰濃縮試験時間 5 水準とし、合計ケース数は 3×3×5=45 ケースとし た。液位は加熱開始前において、発熱部頂部(TAF)を基準としてダウンカマ の液位が一定になるように制御した。三水準として TAF, TAF-100mm, TAF-200mm を選定した。これらの値について、実施困難な条件が生じた場合には適宜受注 者との協議に基づき変更を行った。熱流束は定格出力の 0.5, 1.0, 1.5%を目安 に 3, 6, 9 kW/m<sup>2</sup>の三水準とした。

沸騰濃縮時間は 5 水準とした。沸騰濃縮時間は、熱流束が異なるため、目標 濃度を 5 水準に定めて熱流束毎に異なる値を設定することにした。発熱部沸騰 濃縮濃度を簡易に評価する方法を検討する。加熱量Qにより溶液が沸騰蒸発す る場合を考える。沸騰蒸発量は体積Vの時間変化として以下の式で表せる。

$$\rho_s h_{gl} \frac{dV}{dt} = Q \tag{1}$$

 $\rho_s$ は流入塩水密度(kg/m3)、 $h_{gl}$ は蒸発潜熱(J/kg)、tは時間、である。Qは受熱量である。初期塩水濃度 $c_0$ は初期塩水密度 $\rho_0$ 、初期体積 $V_0$ 、初期重量 $m_0$ と以下の関係にある。

$$c_0 = \frac{m_0}{\rho_0 V_0} \tag{2}$$

塩水が流入して、水蒸気として流出すると考えると、蒸発して損耗した溶液量が塩水として注入されると考えると、それぞれの溶液体積は同じであることから、時間t(s)におけるこの体積を $\Delta V$ (m<sup>3</sup>)と記す。水の密度を $\rho_l$ (kg/m<sup>3</sup>)を用いると、塩水の濃度c(-)は次式で表される。

$$c = \frac{m_0 + (\rho_s - \rho_l)\Delta V}{\rho_0 V_0 - \rho_l \Delta V + \rho_s \Delta V}$$
(3)

沸騰濃縮時間tは、初期塩水濃度c<sub>0</sub>から塩水濃度cに濃縮されるまでの時間として、式(2)を式(3)に代入することで、次式で表される。

$$t = \frac{c - c_0}{1 - c} \frac{\rho_0 \rho_l}{\rho_s - \rho_l} \frac{h_{gl} V_0}{Q}$$
(4)

目標濃度の5水準を20,30,40,50,60 wt%と設定した場合の沸騰濃縮時間を式 (4)を用いて算出した。表 3-7 に熱流束の関数として、沸騰濃縮時間を記載した。 なお、沸騰濃縮時間は式(4)にも示される通り、液位に関係ない値である。

表 3-8 に試験条件の命名法を示す。試験条件の略称は 8 桁の英数字で記載する。最初の 4 文字は試験パラメータ値を、続く 4 文字は試験日の月と日を表す。 一例として、「SM2H0108」は溶液が海水、液位は TAF-100mm、試験時間は 30%濃縮相当、出力は 3.75kW、試験日が 1 月 8 日を示す。

表 3-7 短尺バンドル内沸騰濃縮試験パラメータ

定格出力	%	0.5	1.0	1.5
熱流束	kW/m <sup>2</sup>	3.0	6.0	9.0
バンドル出力	kW	1.25	2.50	3.75
		目標塩水液	農度に到達す	る試験時間
塩水濃度wt%	20	1:03:38	0:31:49	0:21:13
	30	2:16:56	1:08:28	0:45:39
	40	3:54:41	1:57:21	1:18:14
	50	6:11:32	3:05:46	2:03:51
	60	9:36:48	4:48:24	3:12:16
	60	9:36:48	4:48:24	3:12:16

試験時間の単位は「時:分:秒」である。

注: コラプスト液位は TAF, TAF - 100 mm, TAF - 200 mm の三水準である。 上記パラメータは液位に依らず共通である。

### 表 3-8 短尺バンドル試験条件の命名法

溶液	液位	時間	出力	日付	
S:海水	L:低, TAF-200mm	1:20%濃縮相当	L:低, 1.25kW	MMDD	
B:ホウ酸水	M:中, TAF-100mm	2:30%濃縮相当	M:中, 2.50kW	月日の 4桁	
	H:高 TAF	3:40%濃縮相当	H:高, 3.75kW		
		4:50%濃縮相当			
		5:60%濃縮相当			

一例として、「SM2H0108」は溶液が海水、液位はTAF-100mm、試験時間は 30%濃縮相当、出力は3.75kW、試験日が1月8日を示す。

#### 3.3.7. 沸騰濃縮試験結果

表 3-9 に沸騰濃縮試験結果を示す。4 条件では目標の沸騰濃縮時間に至らず に途中で停止した。該当する4条件では、沸騰濃縮時間を赤色で記載し、目標 時間と対比した。残りの 41 条件では、目標通りの沸騰濃縮時間である。目標 時間に達しなかった理由は後述する。液位が TAF (TAF 基準 - 0 m)の条件で は2条件において、突沸が顕著となりバンドルヒータ内の海水が所定濃度まで に濃縮されないと判断した。突沸が発生した際には、上部オーバーフロー管よ り溶液がオーバーフローし、下降管より頻繁に補給される状況になる。残りの 2条件では、液位が TAF - 200 mm の条件で、上部ヒータ表面温度が警報温度 (250℃)を超えたことにより、安全回路が動作し、試験を中断せざるを得な かった。以下にそれぞれの状況を試験番号共に示す。

- 試験番号 9:沸騰開始から2時間7分後以降に突沸が継続した。溶液の消費量 が増加し、回復が見込めないため、目標時間に達する前に試験 を終了した。
- 試験番号 10:突沸が発生するため、オーバーフロー管に止栓をして試験を実施 した。沸騰開始から1時間27分後、1時間32分後、3時間28分 後に液位アラームあり、沸騰開始から約1時間40分後以降、溶 液の消費量が増加しはじめ、溶液タンク内の溶液を使い果たし たため、目標時間に達する前に試験を終了した。
- 試験番号 35:試験開始直後に上部ロッド表面温度の上昇がみられたため、液位 の下限側を 0.2 kPa 高く設定した。これにより試験は継続できた が、試験体のポリカーボネイト製の筐体内面に熱損傷の可能性 が認められたため、沸騰開始から 8 時間 7 分後に試験を終了し た。
- 試験番号45: 沸騰開始から2時間9分後に上部ヒータロッド表面温度が警報温 度を超えたため、安全装置が働き電源がトリップした。温度が 200℃以下となったのを確認し、4分後に電源を入れたが、再度 トリップした。このため、沸騰開始から2時間23分後に試験を 終了した。試験後、ポリカーボネイト製筐体に熱による気泡の 発生が認められた。

図 3-17 から図 3-61 に 45 条件に対する X線 CT 撮影像をそれぞれ示す。1 条件 当たり代表的な 6 枚の写真を掲載している。最初の図(図 3-17)のみ、6 枚の 図の意味を記載した。左上段が TAF 部の水平断面、右上段がスペーサ部の水平 断面である。左中段は TAF 部の画像で有り、青線で示した Y 方向対角断面が右 中段の鉛直断面である。同様に赤線で示した X 方向対角断面が左下段の鉛直断 面である。右下段には透明ポリカーボネイト容器を画像処理により削除した三 次元画像を示す。

各試験条件の影響を鳥瞰するために、TAF部(表 3-10~表 3-12)、スペーサ 部(表 3-13~表 3-15)、並びに鉛直断面(表 3-16~表 3-18)について撮影画像 を並べて示す。それぞれの表は試験条件の液位毎に整理しており、液位が TAF、 TAF - 100 mm、TAF - 200 mmの順で記載した。水平断面では、横方向に熱流束 の変化を、縦方向に沸騰濃縮時間(目標濃度)の変化を示している。鉛直断面 では写真のアスペクト比からその逆の構成としており、横方向に沸騰濃縮時間 (目標濃度)の変化を、縦方向に熱流束の変化を示している。

析出塩の分布を鳥瞰すると、沸騰濃縮試験時間が長くなるほど、塩の析出が 顕著になる。目標塩水濃度が濃くなるため、当然の帰結である。鉛直方向の析 出では、スペーサ部(高さ TAF - 250 mm)より、TAF の方が析出量が多い。 TAF より上の非加熱部では、析出量が顕著に減少することが分かる。塩分が飛 来することに加え、表面での蒸発乾固が析出塩の固着に顕著になることを示唆 している。同じ塩分濃度では、熱流束が大きい方が析出が少ない。熱流束が大 きい方が放熱が大きいが、沸騰系においては放熱量の差は小さい。本試験では 沸騰濃縮時間は熱流束に反比例するため、熱流束が大きい方が、試験時間中の 放熱量の積分値は小さくなる。それにもかかわらず熱流束が大きい方が析出量 が少ない原因は、沸騰気泡による攪拌効果であると考えられる。攪拌効果が大 きい高熱流速条件では、塩の固着が抑制されると考えられる。

続いて水平断面において塩の析出分布を考察する。スペーサ部では外周部に 顕著に析出する。前述の通り低熱流束の方が析出が顕著であることから、ボイ ド率変動が小さい外周部で析出しやすいことが原因と考えられる。一方で、上 部では中央部で顕著に析出する。液位が低い場合に析出が顕著となることから、 ヒータロッドに囲まれる中央部では乾き面がより高温になり、塩水が蒸発乾固

し易くなることが原因と考えられる。

表 3-19、表 3-21、表 3-23 に沸騰濃縮試験中の溶液を採取して ICP-MS を用い て元素濃度分析を行った結果を、それぞれ液位 TAF, TAF – 100 mm, TAF – 200 mm に対して示す。表 3-20、表 3-22、表 3-24 は低濃度元素の傾向を把握するた め、それぞれ表 3-19、表 3-21、表 3-23 の縦軸を拡大したグラフである。横軸の 数字は溶液採取位置(図 3-12(c)のサンプリング箇所の上流側からの位置)であ る。

全体の傾向としては、塩濃度が低い時(目標濃度が 20 wt%以下の場合)には 今回確認した 8 種類の元素濃度は全て、下降管内が最も低く、水平連結管から 濃度が高い値を示し、ヒータ内部で高くなっている。これは、下流側の飽和状 態にある濃縮海水が、連結管までは濃度拡散しているが、さらに上流の下降管 までは濃度拡散していないこと示している。

一方、塩濃度が目標濃度が 30 wt%以上の場合は、今回測定した 8 種類の元素 の内、CaとSrを除く6種類は濃度が低い場合と同じ傾向を示した。すなわち下 降管内が最も低く、連結管から濃度が上昇し始め、ヒータ内部で高くなる傾向 を示している。しかしながら Ca及び Sr 濃度は下流側に行くにつれて低くなり、 他の6種類の元素とは異なる挙動を示している。Caは塩濃度の上昇に従って溶 解度の低い炭酸カルシウムなどとなって析出することで溶液中の濃度が減少し たと考えられる。Sr についても溶解度の低い、例えば炭酸ストロンチウムとし て析出したと考えられる。

以上より、短尺バンドル体系での人工海水の沸騰濃縮実験を熱流束、液位、 沸騰濃縮時間をパラメータに 45条件実施し、析出塩の分布を X線 CT 撮影する ことで、パラメータの感度や析出場所の傾向を把握した。

# 表 3-9 沸騰濃縮試験結果

No.	ID	熱流束	TAF基準液	沸騰濃縮時間	備考
	(ファイル名)	$(kW/m^2)$	位 (mm)	(HH:MM:SS)	
1	SH1L0214	3.0	0	1:03:38	
2	SH2L0214	3.0	0	2:16:56	
3	SH3L0213	3.0	0	3:54:41	
4	SH4L0210	3.0	0	6:11:32	
5	SH5L0217	3.0	0	9:36:48	
6	SH1M0220	6.0	0	0:31:49	
7	SH2M0204	6.0	0	1:08:28	
8	SH3M0212	6.0	0	1:57:21	1h47mから突沸発生
9	SH4M0212	6.0	0	<b>2:26:00</b> < 3:05:46	2h07mから突沸発生
10	SH5M0228	6.0	0	<b>3:35:00</b> < 4:48:24	1h40mから突沸発生
11	SH1H0204	9.0	0	0:21:13	
12	SH2H0204	9.0	0	0:45:39	30mから突沸発生
13	SH3H0121	9.0	0	1:18:14	開始時から突沸発生
14	SH4H0221	9.0	0	2:03:51	40mから突沸発生
15	SH5H0227	9.0	0	3:12:16	50mから突沸発生
16	SM1L0205	3.0	-100	1:03:38	
17	SM2L0129	3.0	-100	2:16:56	
18	SM3L0124	3.0	-100	3:54:41	
19	SM4L0123	3.0	-100	6:11:32	
20	SM5L0131	3.0	-100	9:36:48	
21	SM1M0205	6.0	-100	0:31:49	
22	SM2M0203	6.0	-100	1:08:28	
23	SM3M0130	6.0	-100	1:57:21	
24	SM4M0128	6.0	-100	3:05:46	
25	SM5M0127	6.0	-100	4:48:24	
26	SM1H0128	9.0	-100	0:21:13	
27	SM2H0203	9.0	-100	0:45:39	
28	SM3H0130	9.0	-100	1:18:14	
29	SM4H0122	9.0	-100	2:03:51	
30	SM5H0120	9.0	-100	3:12:16	
31	SL1L0205	3.0	-200	1:03:38	
32	SL2L0221	3.0	-200	2:16:56	
33	SL3L0226	3.0	-200	3:54:41	
34	SL4L0224	3.0	-200	6:11:32	
35	SL5L0225	3.0	-200	8:07:00 < 9:36:48	熱損傷の懸念から中断
36	SL1M0219	6.0	-200	0:31:49	
37	SL2M0218	6.0	-200	1:08:28	
38	SL3M0219	6.0	-200	1:57:21	
39	SL4M0207	6.0	-200	3:05:46	
40	SL5M0206	6.0	-200	4:48:24	
41	SL1H0220	9.0	-200	0:21:13	
42	SL2H0220	9.0	-200	0:45:39	
43	SL3H0219	9.0	-200	1:18:14	
44	SL4H0116	9.0	-200	2:03:51	
45	SL5H0117	9.0	-200	<b>2:23:00</b> < 3:12:16	表面温度高により中断

赤字は目標時間より早く終了した時間を示す。



図 3-17 X線CT撮影像による析出塩分布SH1L



図 3-18 X線CT撮影像による析出塩分布SH2L



図 3-19 X線CT撮影像による析出塩分布SH3L



図 3-20 X線CT 撮影像による析出塩分布SH4L



図 3-21 X線CT撮影像による析出塩分布SH5L



図 3-22 X線CT撮影像による析出塩分布SH1M



図 3-23 X線CT撮影像による析出塩分布SH2M



図 3-24 X線CT撮影像による析出塩分布SH3M



図 3-25 X線CT 撮影像による析出塩分布SH4M



図 3-26 X線CT撮影像による析出塩分布SH5M


図 3-27 X線CT撮影像による析出塩分布SH1H



図 3-28 X線CT撮影像による析出塩分布SH2H



図 3-29 X線CT撮影像による析出塩分布SH3H



図 3-30 X線CT撮影像による析出塩分布SH4H



図 3-31 X線CT撮影像による析出塩分布SH5H



図 3-32 X線CT撮影像による析出塩分布SM1L





図 3-33 X線CT 撮影像による析出塩分布SM2L



図 3-34 X線CT撮影像による析出塩分布SM3L



図 3-35 X線CT 撮影像による析出塩分布SM4L



図 3-36 X線CT 撮影像による析出塩分布SM5L



図 3-37 X線CT撮影像による析出塩分布SM1M



図 3-38 X線CT撮影像による析出塩分布SM2M



図 3-39 X線CT撮影像による析出塩分布SM3M



図 3-40 X線CT撮影像による析出塩分布SM4M



図 3-41 X線CT撮影像による析出塩分布SM5M



図 3-42 X線CT 撮影像による析出塩分布 SM1H



図 3-43 X線CT 撮影像による析出塩分布 SM2H





図 3-44 X線CT 撮影像による析出塩分布 SM3H



図 3-45 X線CT 撮影像による析出塩分布 SM4H



図 3-46 X線CT 撮影像による析出塩分布 SM5H



図 3-47 X線CT撮影像による析出塩分布SL1L



図 3-48 X線CT 撮影像による析出塩分布 SL2L



図 3-49 X線CT撮影像による析出塩分布SL3L



図 3-50 X線CT撮影像による析出塩分布SL4L



図 3-51 X線CT 撮影像による析出塩分布 SL5L



図 3-52 X線CT撮影像による析出塩分布SL1M



図 3-53 X線CT撮影像による析出塩分布SL2M



図 3-54 X線CT 撮影像による析出塩分布 SL3M



図 3-55 X線CT 撮影像による析出塩分布 SL4M



図 3-56 X線CT 撮影像による析出塩分布 SL5M



図 3-57 X線CT撮影像による析出塩分布SL1H



図 3-58 X線CT撮影像による析出塩分布SL2H



図 3-59 X線CT撮影像による析出塩分布SL3H



図 3-60 X線CT撮影像による析出塩分布SL4H



図 3-61 X線CT撮影像による析出塩分布SL5H

定格出力	%	0.5	1.0	1.5
熱流束	kW/m <sup>2</sup>	3. 0	6.0	9.0
バンドル出力	kW	1. 25	2.50	3. 75
	20	SHIL 0214	SHIM 0220	SH1H 0204
塩水濃度 Wt%	30	SH2L 0214	SH2M 0204	ССССССССССССССССССССССССССССССССССССС
	40			
		SH3L 0213	SH3M 0212	SH3H 0121
	50			
		SH4L 0210	SH4M 0212	SH4H 0227
	60	SH51 0217	SHEM 0228	SH5H 0227
L		SHOL UZ11	SHDM 0228	5H9H 0221

表 3-10 TAF 高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF)
定格出力	%	0.5	1.0	1.5				
熱流束	kW/m <sup>2</sup>	3.0	6.0	9.0				
バンドル出力	k₩	1.25	2.50	3.75				
	20	SMIL 0205	SMIM 0205	SM1H 0128				
		SMIL 0100	SMIM 0200	5mill 0120				
	30		00000 00000 00000 00000 00000	SM2H 0203				
		5M2L 0125	5MZM 0205	5M2H 0205				
塩水濃度 Wt%	40							
		SM3L 0124	SM3M 0130	SM3H 0130				
	50	00000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	00000 00000 00000 00000 00000	<b>SM4H</b> 0122				
		SNI4L 0123	5m4m 0120	SM411 0122				
	60	00000 00000 00000 00000 00000	00000 00000 00000 00000 00000	SMEH 0120				
	L	SHOL VIOL		5801 0120				

表 3-11 TAF 高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 100 mm)

定格出力	%	0.5	1.0	1.5
熱流束	kW/m <sup>2</sup>	3.0	6.0	9.0
<u>^`ント`ル田力</u>	kW	00000	00000	3.75
	20			
		SLIL 0205	SLIM 0219	SLIH 0220
	30			
		SL2L 0221	SL2M 0218	SL2H 0220
塩水濃度 Wt%	40			
		SL3L 0226	SL3M 0219	SL3H 0219
	50			
		SL4L 0224	SL4M 0207	SL4H 0116
	60			
		5151 0225	JEDMI UZUO	

表 3-12 TAF 高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 200 mm)

定格出力	%	0.5	1.0	1. 5
熱流束	kW/m²	3.0	6. 0	9.0
バンドル出力	kW	1.25	2.50	3. 75
	20	SHIL 0214	000000 00000 00000 00000 00000 00000 0000	00000 00000 00000 00000 00000
		0214	0111m 0220	51111 0204
	30			
		SH2L 0214	SH2M 0204	SH2H 0204
塩水濃度 Wt%	40			
		SH3L 0213	SH3M 0212	SH3H 0121
	50	00000     00000	0     0	SH4H 0227
	60			
L		5H5L 0217	5H9M 0228	Ы 5нэн 0227

表 3-13 スペーサ高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF)

定格出力	%	0.5	1.0	1.5			
熱流束	kW/m <sup>2</sup>	3.0	6.0	9.0			
バンドル出力	kW	1.25	2.50	3.75			
	20						
		SMIL 0205	SM1M 0205	SM1H 0128			
	30						
		SM2L 0129	SM2M 0203	SM2H 0203			
塩水濃度 Wt%	40						
		SM3L 0124	SM3M 0130	SM3H 0130			
	50						
		5M4L 0123	5M4M 0128	5M4H 0122			
	60	00000 00000 00000 00000	00000 00000 00000 00000 00000	00000 00000 00000 00000 00000			
L		SMOL VIOL		50011 0120			

表 3-14 スペーサ高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 100 mm)

定格出力	%	0.5	1.0	1.5
熱流束	$kW/m^2$	3.0	6. 0	9.0
バンドル出力	kW	1.25	2.50	3. 75
	20			
		SL1L 0205	SL1M 0219	SL1H 0220
	30	SL21 0221	SL2M 0218	SL2H 0220
		0221	0210	0220
塩水濃度 ₩t%	40			
		SL3L 0226	SL3M 0219	SL3H 0219
	50	SI 4I 0224	SI 4M 0207	SI 4H 0116
		SL4L 0224	SL4M 0207	SL411 0110
	60			
L		SL5L 0225	SL5M 0206	SL5H 0117

表 3-15 スペーサ高さ水平断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 200 mm)



表 3-16 鉛直断面の析出塩分布一覧(液位 TAF)



# 表 3-17 鉛直断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 100 mm)



# 表 3-18 鉛直断面の析出塩分布一覧(液位 TAF - 200 mm)



# 表 3-19 溶液中の濃度分布(液位 TAF、全濃度範囲)







表 3-21 溶液中の濃度分布(液位 TAF - 100 mm、全濃
------------------------------------



表 3-22	溶液中の濃度分布(液位 TAF -	100 mm,	濃度範囲拡大)
--------	-------------------	---------	---------



表 3-23 溶液中の濃度分布(液位 TAF - 200 mm、全濃度範囲)



# 表 3-24 溶液中の濃度分布(液位 TAF - 200 mm、濃度範囲拡大)

## 4. クラスト・デブリベッド冷却特性

本章では溶融炉心のクラストやデブリベッドの形状を模擬した多孔質体を用いて、塩水中での沸騰濃縮試験を実施し、伝熱特性を把握する。

#### 4.1. クラスト・デブリベッド模擬試験装置

図 4-1 にクラスト・デブリベット試験装置の構造概念を示す。水平上向き伝 熱面上に多孔質体を設置して、沸騰濃縮による伝熱面の温度変化を把握する。 沸騰による液位低下を補うために、伝熱面上部から人工海水を散布するノズル が設置されている。具体的には、液位計測により液位が多孔質体上面より 30 mm を下回ると、人工海水が散布される。人工海水は前節でも用いたマリン アートである。

図 4-2 により具体的な試験装置の概念図を示す。散布ノズルまでの流路に ヒータが巻かれており、散布ノズル出口温度が飽和温度になるように温度調節 されている。上流側の貯水タンクでは人工海水が蒸発により顕著に濃縮しない 程度の温度として 70℃に保持している。

図 4-3 に伝熱面内の熱電対配置図を示す。多孔質体の底部の伝熱面は多孔質体と同じ面積(200 mm×200 mm)で高さ 50 mmのステンレス製矩形ブロックである。矩形ブロックの底面から 10 mm上方を中心位置として直径 10 mmの貫通孔を開け、外径 10 mmで加熱長さ 200 mmのカートリッジヒータを 15 mm間隔で挿入した。この構造を持って、矩形ブロックの上面を均一に加熱できる伝熱面としている。個々のカートリッジヒータには熱電対が埋め込まれており、ヒータ温度の異常な上昇を検知して、加熱電源を遮断する制御を行った。ヒータ表面の上限温度は 400℃とした。

図 4-3 に伝熱面表面に埋め込んだ熱電対の構造図を示す。熱電対は外径 0.5 mmの K型シース熱電対である。伝熱面に直径 0.5 mmの孔を開け、伝熱面裏面から熱電対を挿入し、伝熱面表面が平面となるように研磨した。

図 4-4 に伝熱面表面に埋め込んだ熱電対の配置図を示す。ヒータのピッチに 相当する 15 mm 間隔で熱電対を縦横に配置した。よって、14×14の格子状にな るが、最外周はドライアウトする可能性が低いことから、一点ずつ間引いた配 置としている。

116

図 4-5 にクラスト・デブリベット試験体と伝熱面の概念図を示す。クラスト デブリベット試験体はステンレス容器に囲まれている。壁面を伝わって冷却水 が流下すると多孔質体をバイパスすることになるため、多孔質体側面とステン レス容器の隙間にテフロン薄膜を挿入して流動を抑制した。



図 4-1 クラスト・デブリベット試験装置の構造概念



図 4-2 クラスト・デブリベット試験装置の概念図



91	P4		P5		P6		P7		P8		P9		P10	
		мт	M2	мз	564	M5	Mő	M7	MB	M9	M10	M11	M12	P11
	P3	ы	L2	ы	L4	L.5	Lő	L7	LB	La	L10	L11	L12	
		ंहर	K2	К3	ं K4	KS	K6	K7	КВ	К9	K10	кн	K12	P12
	P2	JT	J2	J3	J4	J5	Jő	J7	JB	J9	J10	JII	J12	
		ास	H2	нз	ाम4	H5	HB	H7	на	HB	H10	ни	H12	P13
	Pī	GI	62	G3	G4	G5	G6	G7	Gŝ	.G9	G10	G11	G12	
		E1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	N13
	NI	EI	E2	E3	E4	E5	Eß	E7	E8	E9	E10	E11	E12	
		DI	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	N12
	N2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	67	C8	C9	C10	C11	C12	
		B1	82	B3	B4	B5	86	B7	BS	89	810	B11	B12	N11
	N3	A1	A2	A3	A4	A5	Aß	A7	AB	AB	A10	A11	A12	
		N4		N5		NB		N7		NB		N9		N10

熱電対配列→

ヒーター結線側

図 4-4 伝熱面熱電対の配置図



図 4-5 クラスト・デブリベット試験体と伝熱面の概念図

#### 4.2. プール沸騰試験パラメータ

表 4-1 に沸騰濃縮試験パラメータを示す。試験条件は、多孔質体の粉末粒径 5 水準と熱流束 3 水準であり、合計ケース数は 5×3=15 ケースとした。昨年度製 作した多孔質体は粉末の中心粒径は 0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 1.2 mm の 5 水準である。ま た熱流束は 20, 40, 60 kW/m<sup>2</sup> である。本研究に於ける熱流束は伝熱面に与えた熱 量を上面の面積(0.200 m×0.2 m = 0.04 m<sup>2</sup>)で除した値である。合計ケース数 は、多孔質体の粒径 5 水準と熱流束 3 水準を掛け合わせ、5 × 3 = 45 ケースで ある。

表 4-2 に試験条件の命名法を示す。試験条件の略称は 8 桁の英数字で記載する。最初の 4 文字は試験パラメータ値を、続く 4 文字は試験日の月と日を表す。 一例として、「S03H0108」は溶液が海水、粉末粒径は 0.3 mm、熱流束は 60 kW/m<sup>2</sup>、試験日が 1 月 8 日を示す。

試験溶液は前述の人工海水マリンアート SF-1 である。前出の表 3-6 に、人工 海水の組成を示す。本試験では、初期および沸騰濃縮中に注液する溶液は共に 人工海水のと同じ濃度で濃縮はしない。すなわち 1 kg のイオン交換樹脂を通し た水に、マリンアート 38 g を溶解させた溶液である。

初期プール液位は多孔質体上面から 50 mm とした。試験に従い蒸発すること になるが、試験時間が短いため液位の減少は小さい。溶液温度は初期から飽和 温度とした。

123

衣4-1 ノール伽鷹迅破ハノノーク	表 4-1	プール沸騰試験パラメータ	r
-------------------	-------	--------------	---

パラメータ	単位	範囲
多孔質体粉末粒径	mm	0.1, 0.3, 0.5, 1.0, 1.2
熱流束	$kW/m^2$	20, 40, 60

## 表 4-2 プール沸騰試験条件の命名法

溶液	粉末粒径	熱流束	日付
S:海水	01:0.1 mm	L:低, 20 kW/m <sup>2</sup>	
W:水	03:0.3 mm	M:中, 40 kW/m <sup>2</sup>	
	05:0.5 mm	H:高, 60 kW/m <sup>2</sup>	MMDD 月日の4桁
	10:1.0 mm		
	12:1.2 mm		

一例として、「S03H0108」は溶液が海水、粉末粒径は0.3 mm、熱流束は60
kW/m<sup>2</sup>、試験日が1月8日を示す。

### 4.3. プール沸騰試験手順

プール沸騰試験の準備として、多孔質体を溶液(水または海水)に浸漬し、 溶液が十分浸透させた。溶液を飽和にするために、マイクロヒータを溶液に浸 漬し、溶液を飽和温度に維持した。

初期伝熱面温度が室温に影響されないように、伝熱面表面温度が 100 ℃になるように伝熱面を加熱した。試験パラメータの熱流束と比較すると、1/5 以下の 熱流束で加熱したことになる。表面温度が時間に対して変化が小さくなったこ とを確認して、目標の熱流束を伝熱面に与えた。この時刻を時間0sと定めた。

全てのデータを2s間隔で収録した。十分な温度変化が得られるまで試験を継続したが、高出力の場合には、パッキンの損傷を防ぐため伝熱面表面温度が400℃になる前に停止した。

## 4.4. プール沸騰試験結果および考察

伝熱面表面温度を計測する熱電対の指示値はいずれも中心部が最も高く、放 熱の影響を受けやすい周辺部ではやや低い温度を示した。断熱により温度差は 小さく抑制されていることから、事故時のクラスト・デブリベットの広い伝熱 面を均一発熱加熱条件で模擬できていると考えられる。以降の実験では、伝熱 面温度として、中央の4点、すなわち図4-4の熱電対配置図でのG6,G7,F6,F7 の平均値で代表させた。

図 4-6 から図 4-10 に熱流束 20 kW/m<sup>2</sup>の結果を、図 4-11 から図 4-15 に熱流束 40 kW/m<sup>2</sup>の結果を、図 4-16 から図 4-20 に熱流束 60 kW/m<sup>2</sup>の結果を、それぞれ の粒径毎に示す。熱流束が大きいほど、伝熱面表面の温度上昇速度が大きくな る。しかしながら、多孔質体の粉末粒径の影響は小さい。また水と海水との伝 熱面表面の温度上昇における有意な差は見られない。使用した多孔質体は占積 率がいずれも約 50%である。粒径 0.1 mm から 1.2 mm の粒子を密に詰めた多孔 質体では、多孔質体表面で沸騰し、多孔質体内部に水や海水が流入しにくいこ とが流体種類の違いが現れない原因であると考えられる。























図 4-11 伝熱面表面温度の時間変化 W, S01M







図 4-13 伝熱面表面温度の時間変化 W, S05M







図 4-15 伝熱面表面温度の時間変化 W, S12M







図 4-17 伝熱面表面温度の時間変化 W, SO3H











図 4-20 伝熱面表面温度の時間時間変化 W, S12H

### 5. まとめ

海水およびホウ酸水に関する文献を調査し、これらが注水される場合の模 擬炉心である燃料バンドル体系および模擬クラスト・デブリベッドである 多孔質体を対象に除熱性能について実験を行った結果、以下の結論を得た。

### (1) 文献調査

塩化物イオン共存溶液の硫酸カルシウム溶解度の温度依存性や、ホウ酸と 塩化ナトリウム混合溶液の溶解度の温度依存性を調査した。

#### (2) 塩水自動採取装置の改良

海水が沸騰濃縮される場合や、五ホウ酸ナトリウム水溶液が低温で粘性が 高くなることに配慮して、昨年度製造した塩水自動採取装置のマイクロシ リンジや管路をステンレス製に変更し、ヒータを巻いて保温することで、 飽和温度近傍で恒温維持することが可能になった。人工海水と五ホウ酸ナ トリウム水溶液を用いた実験を行い、広い濃度範囲で精度良く自動採取で きることを確認した。

#### (3) 差圧計側方の改良

差圧導管内の塩水濃度変動が差圧計測値に影響することを抑制するため、 導管内にシリコーンを封入した差圧導管構造を設計・製作した。シリコー ンを介して塩分が拡散しないことを実験で確認した。

#### (4) X線CT撮影による短尺バンドル内での海水沸騰濃縮試験

スペーサ間隔に対応する高さ 530 mm の短尺バンドルを作成した。沸騰濃縮 時間と熱流束から濃度を求める式を導出した。人工海水を用いた沸騰濃縮 試験を出力3水準、目標濃度(沸騰濃縮時間)5水準、液位3水準で行った。 三次元X線CTで析出した塩のバンドル内分布を観察した結果、流路が狭く なるスペーサ部分より、ボイド率が高い上部の析出量が多い。発熱部より 上部では析出は顕著に減少する。発熱部上端付近では、中央部での析出が 顕著である。低液位条件で析出が顕著であることから、中央部では乾き面 がより高温になり、塩水が蒸発乾固しやすくなることが原因と考えられる。 スペーサ部では外周側に顕著に析出する。低出力では析出が顕著であるこ とから、ボイド変動が小さい外周側で析出し易いことが原因と考えられる。 ICP-MSを用いた元素濃度分析の結果、Ca及びSr濃度は目標濃度が30wt% 以上の場合は下流側に行くにつれて低くなった。これらは炭酸塩として析 出し、溶液中の濃度を減少させたと考えられる。その他の6元素は水平連結 管に濃度拡散するが、下降管の濃度は低いまま維持されている。

#### (5) クラスト・デブリベット伝熱面の海水沸騰熱伝達試験

多孔質体を伝熱面上に設置したプール沸騰実験装置を製作した。熱流束3水準、多孔質体粒径5水準に対してプール沸騰実験を実施した結果、伝熱面表面の温度上昇は海水と水とで有意な差は得られなかった。昨年度製作した多孔質体の粒径範囲(0.1 mm~1.2 mm)では多孔質体内に溶液が浸透できずに表面沸騰が支配的なために顕著な違いが現れなかったことが原因と考えられる。

紙ヘリサイクル可